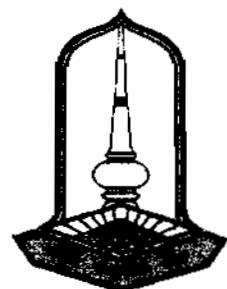


การปักผ้าสีขาวโพแทสเชิ่มน้ำไฮโดรเจนฟอสเฟตที่ถูกจีด้วยไคร์โแกซชีนชั้บทึบ
แบบทิศทางเดียวและการกำหนดถักขยะเฉพาะ

เกียรติศักดิ์ จันทร์อุป

รายงานวิชาโครงงานพิสิเกส
เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพิสิเกส
พฤษภาคม 2556
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



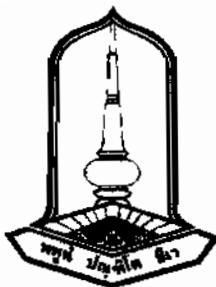


**UNIDIRECTIONAL GROWTH OF TRIGLYCINE SULPHATE DOPED POTASSIUM
DIHYDROGEN PHOSPHATE SINGLE CRYSTALS AND ITS CHARACTERIZATION**

KEATTISAK CHANOUP

**PRESENTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS, MAHASARAKHAM UNIVERSITY
MAY 2013
ALL RIGHTS RESERVED BY MAHASARAKHAM UNIVERSITY**





การปักธงชัยฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
แบบทิคทางเดียวและการกำหนดลักษณะเฉพาะ

เกียรติศักดิ์ จันทร์อุป

รายงานวิชาโครงงานพิสิกรรมได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารพิสิกรรม

คณะกรรมการคุณสอบ

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรณ ฤทธิเดช)

กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ปรีดา เหลาภูล)

กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวงศ์)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

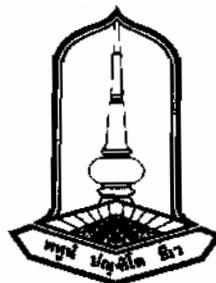
(อาจารย์ ดร.สุกกร หาญสูงเนิน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์)

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556





Unidirectional Growth of Triglycine Sulphate Doped Potassium Dihydrogen Phosphate Single Crystals and Its Characterization

Keattisak Chanoup

The physics project has been approved to be partial fulfillment of requirements for the bachelor degree of science in physics.

Examining Committee

A. RittidechChairperson

(Assistant Professor, Dr. Aurawan Rittidech)

Paveena LaokulMember

(Dr. Paveena Laokul)

Supachai RitjareonwattuMember

(Dr. Supachai Ritjareonwattu)

Supakorn HarnsoongnoenCo-advisor

(Dr. Supakorn Harnsoongnoen)

U. Charoen-InAdvisor

(Dr. Urit Charoen-In)

Date 7th May 2013



กิจกรรมประจำ

โครงการพิสิกส์ฉบับนี้คุ้ล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องด้วยได้กำลังใจจากบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดและสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาและขอบพระคุณหัวหน้าภาควิชาพิสิกส์ อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ ปานะจะ ขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัฒุ และอาจารย์ ดร.สุกร หาญสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ให้ความกรุณาและความช่วยเหลือให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ รวมถึงการหาข้อมูลเอกสาร ในการทำโครงการพิสิกส์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำในการตรวจแก้ไขโครงการพิสิกส์จนบรรทัดทั้งโครงการพิสิกส์ครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำภาควิชาพิสิกส์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาพิสิกส์ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ทั้งในด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำโครงการ

ขอขอบคุณศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SEM และ FT-IR

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ XRD dielectric และ ferroelectric

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา รวมทั้งกำลังใจจากทุกคนทำให้โครงการครั้งนี้สำเร็จ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณงามความดีของโครงการนี้แด่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้โครงการพิสิกส์สำเร็จไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจงานด้านนี้

เกียรติศักดิ์ จันทร์อุป



ชื่อโครงการ	: การปัจกผลึกเดี่ยวโพแทสเซียมไดไฮดรอเจนฟอสเฟตที่ถูกเจือด้วยไตรไกลซีนชั้นเพ็ตแบบทิศทางเดียวและการกำหนดลักษณะเฉพาะ	
ผู้ศึกษาค้นคว้า	: นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์ ดร. อุดมธรรม เจริญอินทร์	
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	: อาจารย์ ดร. สุภกร หาญสูงเนิน	
ปริญญา	: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม	
มหาวิทยาลัย	: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ 2556	

บทคัดย่อ

โพแทสเซียมไดไฮดรอเจนฟอสเฟต (KDP) เป็นสารอินทรีย์มีสมบัติทัศนศาสตร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น โดยปกติถูกใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การผลิตยาาร์ดติสก์ การเพิ่มประสิทธิภาพของเลเซอร์ ทำให้ KDP ถูกศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของผลึกอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามผลึก KDP มีข้อจำกัดในการใช้งานสมบัติเพื่อรองรับอิเล็กทริก ซึ่งการปรับปรุงสมบัติเพื่อรองรับอิเล็กทริกของผลึก KDP สามารถทำได้โดยการเจือสารลงในโครงสร้างของผลึก ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสมบัติเพื่อรองรับอิเล็กทริกของผลึก KDP ด้วยการเจือสารไตรไกลซีนชั้นเพ็ต (TGS) โดยศึกษาที่ความเข้มข้นของสารเจือ 2% mol และ 5% mol การปัจกผลึกมี 2 วิธีคือ การปัจกผลึกแบบตั้งเดิมและการปัจกผลึกแบบทิศทางเดียว ผลึกที่ปัจกได้จากห้องปฏิบัติการ 2 วิธี ถูกนำมาศึกษาสมบัติต่างๆ การศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เมื่อทำการเจือสาร TGS พบว่ามีสเปกตรัมการเลี้ยวเบนที่ตรงกับผลึก KDP บริสุทธิ์ ประกอบกับการศึกษาหมู่ฟังก์ชันในช่วงเลขคณิตต่างๆ ได้แสดงหมู่ฟังก์ชันที่เป็นเอกลักษณ์ของผลึกห้องปฏิบัติการ แต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของผลึก KDP ที่ถูกเจือ การศึกษาลักษณะพื้นผิวพบว่าผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS มีลักษณะเป็นแห่งยาง ภาพที่ได้อาจเป็นภาพของสารละลายที่เหลือค้างระหว่างการเก็บผลึก ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึก KDP มีค่าเท่ากับ 73 และผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS มีค่าเท่ากับ 53 การศึกษาผลของวิธีการปัจกผลึกต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริก พบร่วมกับผลึกที่ปัจกแบบตั้งเดิมมีค่าเท่ากับ 73 ในขณะที่ผลึกที่ปัจกแบบทิศทางเดียวมีค่าเท่ากับ 60 ในสภาวะที่ทดสอบด้วยความถี่ 100 Hz การศึกษาสมบัติเพื่อรองรับอิเล็กทริก ไม่พบสมบัติเพื่อรองรับอิเล็กทริกของผลึก KDP ห้องที่ถูกเจือและไม่ถูกเจือ แต่แสดงลักษณะสมบัติตัวด้านทานแบบเชิงเส้นในอุดมคติ



Title : Unidirectional Growth of Triglycine Sulphate Doped Potassium Dihydrogen Phosphate Single Crystals and Its Characterization
Author : Mr. Keattisak Chanoup
Adviser : Dr. Urit Charoen-In
Co-Adviser : Dr. Supakorn Harnsoongnoen
Degree : Bachelor of Science in Physics (B.Sc.Physics)
University : Mahasarakham University **Date** 2013

Abstract

Potassium dihydrogen phosphate (KDP) is an organic compound and has nonlinearly optical properties. KDP has been used widely in electronic applications, such as hard drives and lasers. However KDP has some limitations in its ferroelectric properties due to the low ferroelectricity. Improvements in ferroelectricity can be achieved by adding some dopants. The aim of this research is to enhance the ferroelectricity of KDP. In this research, two methods were used to grow KDP crystals. They were conventional and unidirectional Sankaranarayanan and Ramasamy (SR) methods. Triglycine sulphate (TGS) was doped into KDP at the concentrations of 2 and 5% mol. The XRD spectra of the grown crystals were investigated. The doped KDP has similar spectrum to that of the pure KDP. FT-IR was used to study functional groups in the lattice. These results show that TGS was probably a substitutional dopant. However, TGS did not change the structure of KDP. The crystal surface of KDP was studied using SEM. The rod-like surface of the crystal shows the influence of TGS on the growth direction in the KDP crystals. The relative dielectric constant of the crystals were measured at 100 Hz. When pure KDP was grown by the conventional methods, it has the relative dielectric constant of 73. When grown by the unidirectional technique, the pure KDP has relative dielectric constant of 60. The pure KDP has the relative dielectric constant of 73, while the KDP doped TGS with 5% mol has the relative dielectric constant of 53. The result did not show any ferroelectricity in case of both the doped and pure KDP crystals, but the characteristics of the ideal resistor.



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	จ
สารบัญรูปภาพ.....	ช
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัสดุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 สถานที่ทำโครงการ.....	3
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	3
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 ผลึก.....	4
2.2 เทคนิคการปลูกผลึกจากสารละลาย.....	8
2.3 สารเคมี.....	10
2.4 เทคนิคการวิเคราะห์สมบัติของผลึก.....	12
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	19
3. ขั้นตอนการปลูกผลึก.....	23
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี.....	23
3.2 แผนผังการดำเนินงานและขั้นตอนการปลูกผลึกแบบดั้งเดิม.....	24
3.3 แผนผังการดำเนินงานและขั้นตอนการปลูกผลึกแบบพิเศษทางเดียว.....	26
4. ผลการทดลองและอภิปรายผล.....	28
4.1 ลักษณะและอัตราการเจริญเติบโตของผลึก.....	28
4.2 การศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์.....	30
4.3 การศึกษาหมุนฟังก์ชัน.....	31
4.4 การศึกษาลักษณะสัญญาณวิทยา.....	33
4.5 การศึกษาสมบัติโดยอิเล็กทริก.....	34
4.6 การศึกษาสมบัติเพื่อปริอิเล็กทริก.....	35



สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	38
5.1 สรุปผลการทดลอง.....	38
5.2 ปัญหาข้อเสนอแนะ.....	39
บรรณานุกรม.....	40
ภาคผนวก.....	43
ประวัติผู้ศึกษา.....	46



สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 แผนแม่ตั้งที่ใช้กับมุ่นระหว่างแผนของระบบผลีกต่างๆ.....	หน้า 5
---	--------



สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 แผนภาพสเปชแอลดิทซ..	4
ภาพที่ 2.2 หน่วยเซลล์มาตรฐาน 14 แบบ แบ่งตามหลักการของบราร์เวส..	6
ภาพที่ 2.3 การกำหนดแกนโคงอร์ดีเนตสาหรับระบบดัชนี 3 ตัว..	6
ภาพที่ 2.4 เวกเตอร์ระบุทิศทาง [111] [121] [100] [0-1-1]..	7
ภาพที่ 2.5 รูปแบบ (211) (111) (110) (1-2-1)..	8
ภาพที่ 2.6 ความสามารถในการละลายของสารโดยทั่วไป..	9
ภาพที่ 2.7 การปัจกผลึกแบบทิศทางเดียว..	10
ภาพที่ 2.8 โครงสร้างผลึกแบบเตตรานโกล..	10
ภาพที่ 2.9 ลักษณะอัณฑูตของผลึก KDP..	11
ภาพที่ 2.10 ลักษณะผลึกไตรไพลซินชัลเฟต..	12
ภาพที่ 2.11 เครื่อง Bruker's X-ray diffraction D8-discover..	13
ภาพที่ 2.12 เครื่อง PERKIN ELMER spectrum GX FT-IR system..	14
ภาพที่ 2.13 เครื่อง JEOL JSM-6460LV SEM..	15
ภาพที่ 2.14 เครื่อง Agilent E4980A..	16
ภาพที่ 2.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง E-P ของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก..	17
ภาพที่ 2.16 ความสัมพันธ์ระหว่าง E-P ของเครื่องมือวัด..	18
ภาพที่ 2.17 สเปกตรัมรูปแบบต่างๆ ของผลึก KDP ..	19
ภาพที่ 2.18 สเปกตรัมรูปแบบต่างๆ ของผลึก TGS..	20
ภาพที่ 2.19 สเปกตรัมการส่งผ่านจากเครื่อง FT-IR ของผลึก KDP..	20
ภาพที่ 2.20 สเปกตรัมการส่งผ่านจากเครื่อง FT-IR ของผลึก TGS..	21
ภาพที่ 2.21 ลักษณะพื้นผิวของผลึก KDP..	21
ภาพที่ 2.22 ความสัมพันธ์ค่าเพลาไรเรซันกับค่าสนามไฟฟ้าของผลึก TGS..	22
ภาพที่ 3.1 แผนผังการดำเนินงานและขั้นตอนการปัจกผลึกแบบดั้งเดิม..	24
ภาพที่ 3.2 แผนผังการดำเนินงานและขั้นตอนการปัจกผลึกแบบทิศทางเดียว..	26
ภาพที่ 4.1 ผลึกปัจกแบบวิธีดึง..	28
ภาพที่ 4.2 ผลึกปัจกแบบทิศทางเดียว..	29
ภาพที่ 4.3 อัตราการเจริญเติบโตของผลึกที่ปัจกได..	30
ภาพที่ 4.4 สเปกตรัมการเดี้ยวนของรังสีเอกซ์..	31
ภาพที่ 4.5 สเปกตรัม FT-IR สำหรับการวิเคราะห์หมู่ผิงก์ชันของผลึก..	32
ภาพที่ 4.6 ลักษณะพื้นผิวของผลึกที่ปัจกได..	33
ภาพที่ 4.7 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก..	34
ภาพที่ 4.8 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของผลึก KDP ที่ปัจกแบบดั้งเดิม และผลึก KDP ที่ปัจกแบบทิศทางเดียว..	35
ภาพที่ 4.9 ความสัมพันธ์ของ P และ E..	36



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ประวัติของการเกิดผลึกเริ่มต้นจากการสังเกตเห็นการเกิดของเกลือในน้ำทะเลโดยการระเหย ซึ่งเป็นวิธีเก่าแก่ของการเกิดผลึก สำหรับพื้นฐานการเกิดผลึกได้รับมาจากในศตวรรษที่ 18 ถึง 19 จากความเข้าใจถึงทฤษฎีของอุณหพลศาสตร์และการพัฒนาการเกิดนิวเคลียสและทฤษฎีเจริญเติบโตของผลึก [1] การที่มนุษย์มีความรู้ในเรื่องเกิดผลึก มนุษย์ได้รู้จักกับผลึกชนิดต่างๆ เป็นเวลากนานและมีการนำมามีใช้ประโยชน์ในสังคม เช่น โลหะ และสารกั่งดัวนำ เป็นต้น แต่การนำมายังงานสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ยังมีข้อจำกัดทำให้ผลึกเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาพัฒนาหรือสังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ผลึกมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการปัลอกผลึกเป็นสิ่งสำคัญมากต่ออุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า แสงอุตสาหกรรมต่างๆ ประโยชน์ของการพัฒนาเทคโนโลยีการปัลอกผลึกทำให้เกิดสิ่งต่างๆ เช่น เครื่องตรวจจับรังสี เครื่องขยายเสียง เลนส์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีการปัลอกผลึกสามารถแสดงได้ว่าผลึกเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกสาขาทั้งพิสิกส์ เคมี สตุศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ได้อย่างชัดเจน เทคโนโลยีการปัลอกผลึกถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการปัลอกผลึกโดยวิธีต่างๆ เช่น การปัลอกจากสารละลาย การปัลอกแบบเจล การปัลอกจากการหลอมละลาย การปัลอกแบบไอล หรือปัลอกผลึกตามต้องการแบบลักษณะเฉพาะโดยการควบคุมสมบัติ เช่น การปัลอกผลึกจำพวก GaAs และ InP ที่ต้องปัลอกในอุณหภูมิที่สูง อย่างไรนั้นย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น ภายใต้กระบวนการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตหรืออุปกรณ์ในการทดลอง ดังนั้นจึงมีการคิด หรือจัดทำอุปกรณ์หัววิธีการปัลอกที่ให้ผลึกตามความต้องการ

เทคโนโลยีการปัลอกมี 2 ลักษณะ แบ่งตามสภาพการเกิด คือ ผลึกที่เกิดการหลอมละลาย (growth from melt) และผลึกที่เกิดจากตกผลึกของสารละลาย (solution growth) ซึ่งการปัลอกผลึกจากสารละลายสามารถทำได้ง่ายและใช้เวลาประมาณที่ไม่สูงใช้สตุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถหาได้ภายในประเทศ กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการปัลอกผลึกเชิงทัศนศาสตร์แบบปัมเป็นเชิงเส้น (nonlinear optic) มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำมาใช้สำหรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับไฟต่อนสำหรับเก็บข้อมูลและการประมวลผลภาพ

ผลึกเชิงทัศนศาสตร์แบบปัมเป็นเชิงเส้น มีสมบัติในการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ของแสงที่มีความเข้มสูงเมื่อแสงผ่านวัสดุดังกล่าว การสังเคราะห์ผลึกเชิงทัศนศาสตร์แบบปัมเป็นเชิงเส้นมีข้อดีคือสามารถปัลอกได้ง่ายโดยวิธีพื้นฐานของการปัลอกผลึก โดยเตรียมจากสารอินทรีย์และสารอินทรีย์ที่สามารถละลายน้ำได้ สมบัติของผลึกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเข้มข้นและอุณหภูมิ

ผลึกโพแทสเซียมไดไฮดรเจนฟอสเฟต (potassium dihydrogen phosphate; KDP) เป็นผลึกเชิงทัศนศาสตร์แบบปัมเป็นเชิงเส้นชนิดหนึ่ง สามารถเจริญเติบโตได้ดีมีขนาดที่ใหญ่ ด้วยการปัลอกผลึกจากสารละลาย โดยให้ตัวทำละลายระเหยไปอย่างช้าๆ [2] ผลึก KDP ถูกนำไปใช้งานได้



หลากหลาย เช่น ถูกใช้ในการสร้างสารโมนิกที่สอง สาม และสี่เพื่อเพิ่มความถี่ของเลเซอร์ ถูกใช้เป็นชัตเตอร์สำหรับการถ่ายภาพความเร็วสูง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การนำผลึก KDP มาใช้งานยังมีข้อจำกัด ซึ่งต้องมีการพัฒนาสมบัติของผลึก KDP ให้ดีขึ้น การพัฒนาสมบัติของผลึกทำได้หลายวิธี เช่น โครงการนี้สนใจวิธีการเจือสารเข้าไปในโครงสร้างผลึก โดยสมบัติด่างๆ ที่แสดงออกมาก็คืออยู่กับสารที่เจือเข้าไป ในงานวิจัย [3] เป็นการศึกษาผลของการปลูกผลึก KDP โดยการเจือสาร KCl เข้าไปในกระบวนการการปลูก โดยพบว่าการเจือ KCl ช่วยให้ผลึก KDP มีสมบัติที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาการเจือ L-aspartic acid และ Ti⁺ [4,5] เป็นต้น

จากการรายในงานวิจัยด่างๆ มีการศึกษาการเจือสารที่ต่างกัน โดยโครงการนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาสมบัติของผลึก KDP โดยการเติอกสารไตรไกลซีนซัลเฟต (tri-glycine sulphate; TGS) เป็นสารเจือเข้าไปในผลึก KDP โดย TGS เป็นสารชนิดใหม่ มีลักษณะเด่นคือสามารถเปลี่ยนแปลงสมบัติเพื่อปรับเปลี่ยน [6] มีการนำ TGS มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกษามากมาย โดยสนใจการปลูกผลึกแบบดึงเดินและการปลูกผลึกแบบทิศทางเดียว (SR) ในงานวิจัย [7] พบว่าการปลูกด้วยวิธีดังกล่าวเหมาะสมสำหรับการปลูกผลึกหัศเศียรแบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยนำผลึกที่ได้จากการทดลองมาศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ

1.2 วัสดุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาการปลูกผลึกเดียวโพแทสเซียมไดไฮಡ্রเจนฟอสเฟตที่เจือด้วยไตรไกลซีนซัลเฟต

1.2.2 เพื่อศึกษาศึกษาและเปรียบเทียบการกำหนดลักษณะเฉพาะต่างๆ ของผลึกที่ปลูกได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ใช้สารโพแทสเซียมไดไฮಡ্রเจนฟอสเฟตเป็นสารหลักในการปลูกผลึกจากสารละลายด้วยวิธีดึงเดิน

1.3.2 ใช้สารไตรไกลซีนซัลเฟตเป็นสารที่เจือเพื่อศึกษาสมบัติที่เปลี่ยนแปลง

1.3.3 อะบิยาลักษณะโครงสร้างและสัญญาณวิทยาของผลึกโดยวิธีการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction; XRD)

1.3.4 ศึกษาหมุนผังรัชน์ที่เป็นองค์ประกอบของผลึกโดยใช้เทคนิค Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)

1.3.6 อะบิยาลักษณะพื้นผิวของผลึกที่สังเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิค scanning electron microscope (SEM)

1.3.7 อะบิยาสมบัติโดยอิเล็กทริกโดยแบ่งออกเป็นค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (dielectric constant) และค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริก (dielectric loss)

1.3.8 อะบิยาสมบัติเพอร์โริอิเล็กทริก (ferroelectric)



1.4 สถานที่ทำโครงการ

- 1.4.1 ภาควิชาพัฒนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.4.2 ศูนย์เครื่องมือภาษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1.5.1 สามารถนำผลจากการศึกษาการปฐกพลีกไฟแทบทะเสียงได้โดยเจนฟอสเฟตแบบทิศทางเดียวที่ถูกเจือด้วยไตรไกลซีบชัลเพตไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
1.5.2 สามารถปฐกพลีกไฟแทบทะเสียงได้โดยเจนฟอสเฟตที่ถูกเจือด้วยไตรไกลซีบชัลเพตจากวิธีแบบดั้งเดิมและแบบทิศทางเดียว
1.5.3 สามารถถูกลักษณะเฉพาะของผลึกไฟแทบทะเสียงได้โดยเจนฟอสเฟตที่ถูกเจือด้วยไตรไกลซีบชัลเพต



บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับผลึก วิธีการปัลกผลึก โดยเน้นการปัลกผลึกจากสารละลาย ประกอบด้วยการปัลกแบบดั้งเดิมและแบบทิศทางเดียว และรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบสมบัติของผลึก ซึ่งมีรายละเอียดและหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 ผลึก

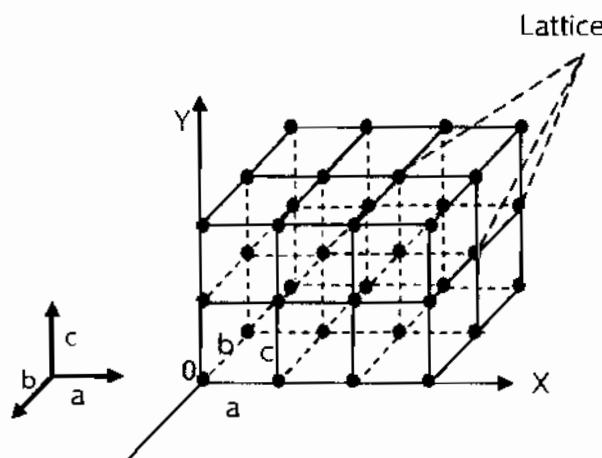
ผลึก ประกอบด้วย อะตอม ไอออน โมเลกุล มีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ยึดกันด้วยแรงชนิดต่างๆ ประกอบกันในลักษณะที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอน สำหรับผลึกบางอย่างอาจมีรูปแบบผลึกได้หลายแบบ เรียกว่า ปราภูมิการณ์อัญญรูป (polymorphism) เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น แต่ผลึกบางชนิดที่ต่างกันอาจมีรูปแบบผลึกเหมือนกัน เช่น NaCl KCl MgO เป็นต้น เรียกว่า ภาวะรูปร่างเหมือนกัน (isomorphism)

ขนาดของผลึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาวะขณะที่เกิดเป็นผลึก โดยผลึกขนาดใหญ่ จะเกิดจากการตกผลึกข้าว ในสารละลายที่อิ่มตัวยังขาดเสื่อมน้อย เช่น ผลึกที่เกิดในธรรมชาติมักจะมีขนาดใหญ่ แต่ถ้ามีการตกผลึกอย่างรวดเร็วจากสารละลายที่อิ่มตัวยังขาด จะได้ผลึกที่มีขนาดเล็ก โดยอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ขนาดผลึกอาจเป็นสิ่งที่แสดงถึงสภาวะการเติบโต ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบโครงสร้างของผลึก

2.1.1 ระบบโครงสร้างผลึก

โครงสร้างผลึกประกอบขึ้นจากจุดพื้นฐานต่อกันอย่างเป็นระเบียบซึ่กันไปทั้งสามทิศทาง โดยระบบจุดที่ประกอบกันขึ้นเป็นโครงข่าย เรียกว่า สเปซลัตติช (space lattice) แสดงดังภาพที่

2.1



ภาพที่ 2.1 แผนภาพสเปซลัตติช [8]

หน่วยเซลล์ (unit cell) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแสดงลักษณะของผลึกได้ โดยความยาวด้านทั้งสามและขนาดมุมทั้งสามของหน่วยเซลล์เรียกว่า แลตทิซพารามิเตอร์ (lattice parameters) ซึ่งแลตทิซพารามิเตอร์และสมบัติความสมมาตรของผลึกเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดสมบัติด้วย ของผลึก เช่น ความแข็ง การดูดกลืนแสงและแบบพลังงานของอิเล็กตรอน โครงสร้างผลึกประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ แลตทิซ และ เบซิส (หรือ โมโนฟ)

แลตทิซ คือ โครงข่าย 3 มิติ จุดตัดของโครงข่ายเรียกว่า จุดแลตทิซ

เบซิส หรือ โมโนฟ คือ อะตอม อิオน ที่เรียงตัวอยู่ตามจุดของแลตทิซ

ดังนั้น ผลึกคือแลตทิซที่มีเบซิสเข้าไปอยู่ที่จุดแลตทิซอย่างสม่ำเสมอ

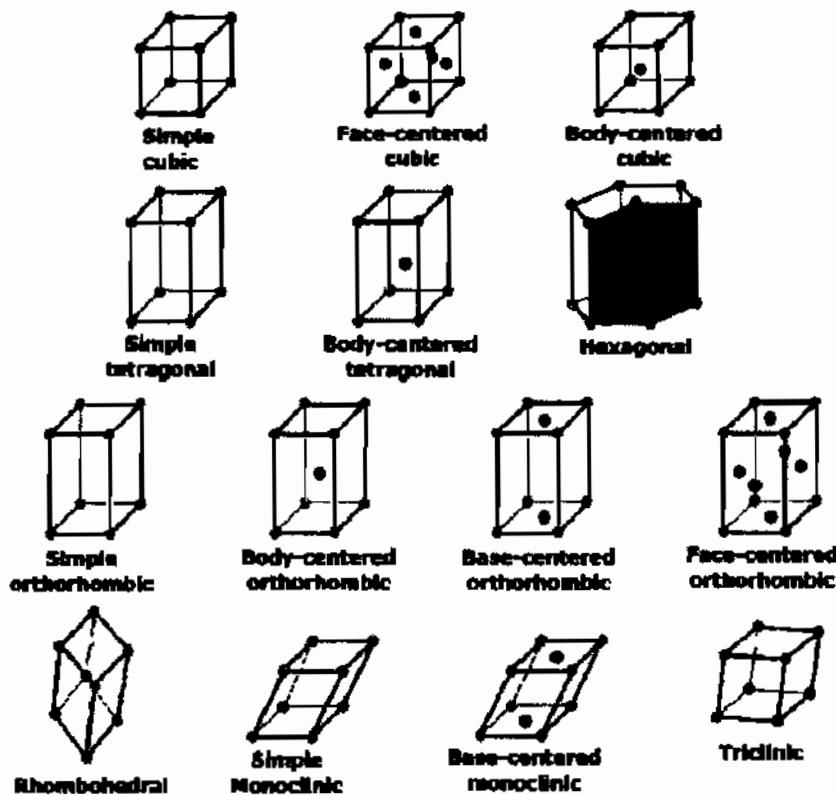
ในธรรมชาติมีการจัดเรียงจุดแลตทิซหลายแบบ ประกอบกับเบซิสแตกต่างกันไปตามชนิดของผลึก ทำให้แลตทิซพารามิเตอร์ต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผลึกที่มีแลตทิซพารามิเตอร์คล้ายกันจะมีสมบัติเหมือนกัน ดังนั้น จึงมีการจัดรูปแบบโครงสร้างผลึกโดยใช้แลตทิซพารามิเตอร์เป็นตัวกำหนดกลุ่มของโครงสร้างผลึก ในปี ค.ศ.1848 Auguste Bravais นักลึกวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้เสนอการจัดระบบพื้นฐานของโครงสร้างผลึกไว้หั้งหมด 7 กลุ่ม โดยแบ่งตามความยาวด้านทั้งสามและมุมทั้งสามของหน่วยเซลล์ ดังแสดงตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แทนของแลตทิซกับมุมระหว่างแกนของระบบผลึกต่างๆ

ระบบผลึก	ความยาวด้านของหน่วยเซลล์	ขนาดของมุมของหน่วยเซลล์
ลูกบาศก์	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
เตต拉gonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
อโตรอมบิก	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
โมโนคลินิก	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$
ไตรคลินิก	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
เชกซ์โภโนอล	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
รอมโนบีครัล	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$

จากรอบโครงสร้างพื้นฐานของผลึกทั้ง 7 กลุ่ม สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ simple หรือ primitive (p) body-centred (i) face-centred (f) และ base-centred รวมเป็น 14 แบบ เรียกว่า แลตทิซบรัวเวส (Bravais lattice) หรือ หน่วยเซลล์มาตรฐาน (standard unit cells) แสดงดังภาพที่ 2.2

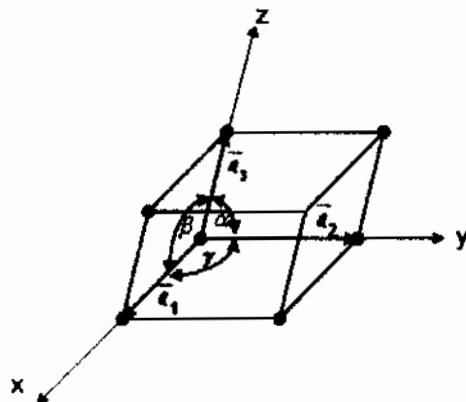




ภาพที่ 2.2 หน่วยเซลล์มาตรฐาน 14 แบบ แบ่งตามหลักการของบราเวส์ [8]

2.1.2 การระบุพิเศษทางและระบบ

การอธิบายโครงสร้างผลึก เพื่อความสะดวกต้องมีการระบุพิเศษทางและระบบในหน่วยเซลล์ วิธีโดยทั่วไปใช้ระบบดั้งนี้ 3 ตัว (three-indices system) โดยพิจารณาค่าของดั้งนี้ดังๆ ที่ใช้ระบบโคออร์ดิเนต 3 แกน คือ x y z ที่วางตัวในแนวของขอบหน่วยเซลล์ขนาดกับแกน \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3 ตามลำดับ ดังภาพที่ 2.3 โดยมีจุดกำเนิดอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของหน่วยเซลล์ซึ่งเป็นจุดร่วมของจุดเริ่มของแกนผลึก \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3



ภาพที่ 2.3 การกำหนดแกนโคออร์ดิเนตสามาหรับระบบดั้งนี้ 3 ตัว [8]

การระบุทิศทาง

การระบุทิศทางเพื่อความสะดวกในการอธิบายโครงสร้างของผลึก ดังนั้น จึงต้องมีการระบุสัญลักษณ์ของทิศทางให้ถูกต้อง โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า ดัชนีมิลเลอร์ (miller index) เขียนแสดงได้โดยการใช้ชุดตัวเลขสามตัวในวงเล็บใหญ่ใช้สำหรับโครงสร้างผลึกทั่วไป เช่น ทิศทาง [100] และ [011] แต่โครงสร้างผลึกแบบเอกซ์ Gon อนิยมใช้ชุดตัวเลขสี่ตัว เช่น ทิศทาง [1100] และ [0111] โดยวิธีการระบุทิศทาง สามารถทำได้ดังนี้

1) เรียนเวคเตอร์ให้มีจุดเริ่มต้นจากจุดกำเนิด แล้วเขียนแนวของเส้นตรงที่ต้องการระบุทิศทางความยาวของเวคเตอร์ ทำให้สะดวกต่อการอ่านตำแหน่งจุดปลาย โดยที่ว่าไปจุดปลายสิ้นสุดที่ผิวขอบหรือมุขของหน่วยเซลล์

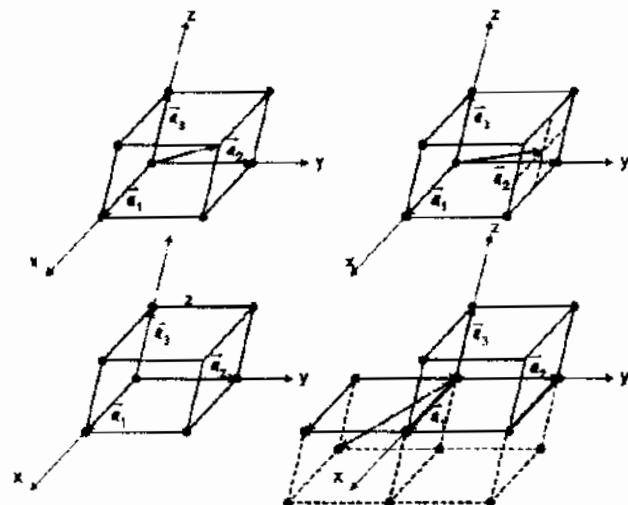
2) จากนั้น อ่านตำแหน่งจุดปลายของเวคเตอร์ในข้อ 1 จะได้ค่า U V W ตามทิศทางแกนทั้งสาม โดย $U V W$ เป็นองค์ประกอบสเกลาร์ของเวคเตอร์ในทิศ $\bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3$

3) ทำให้ $U V W$ เป็นชุดจำนวนเต็มที่น้อยสุด $u v w$ โดยการคูณหรือหารด้วยค่าคงที่ที่เหมาะสม

4) ทิศของเวคเตอร์ในข้อ 1 ระบุได้ในรูป $[u v w]$ โดย $(u v w)$ เป็นพิกัดจุดปลายของเวคเตอร์จากจุดกำเนิดไปยังจุด $u v w$

5) เวคเตอร์ใดเมื่อไม่ผ่านจุดกำเนิด ถ้าไปในทางเดียวกันกับเวคเตอร์ในข้อ 4 จะมีทิศทางเดียวกับเวคเตอร์ในข้อ 4 และระบุทิศทางด้วยดัชนีมิลเลอร์ชุดเดียวกัน

สำหรับพิกัดของจุดที่เป็นเลขลบ การกำหนดทิศทางดัชนีมิลเลอร์ให้ใส่เครื่องหมาย “-” ไว้ด้านบนหรือด้านหน้าของตัวเลข เช่น $1 \bar{2} 0$ หรือ $1 -2 0$ ตัวอย่างการระบุทิศสามารถแสดงดังภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.4 เวคเตอร์ระบุทิศ [111] [121] [100] [0-1-1] [8]

การระบุรูบนาบ

ตัวนี้มิลเลอร์สามารถใช้ในการระบุรูบนาบของโครงสร้างผลึก โดยการใช้สัญลักษณ์เป็นจำนวนเต็ม 3 ตัว เขียนติดกันภายใต้เครื่องหมายจงเล็บ () เช่น (222) (210) (110) เป็นต้น วิธีการหาตัวนี้มิลเลอร์เพื่อระบุรูบนาบให้ๆ สามารถทำได้ดังนี้

1) กำหนดแกน x y z ในทิศทาง $\bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3$ เช่นเดียวกับการระบุทิศทาง

2) หาระยะห์รูบนาบทั้งแกน x y z

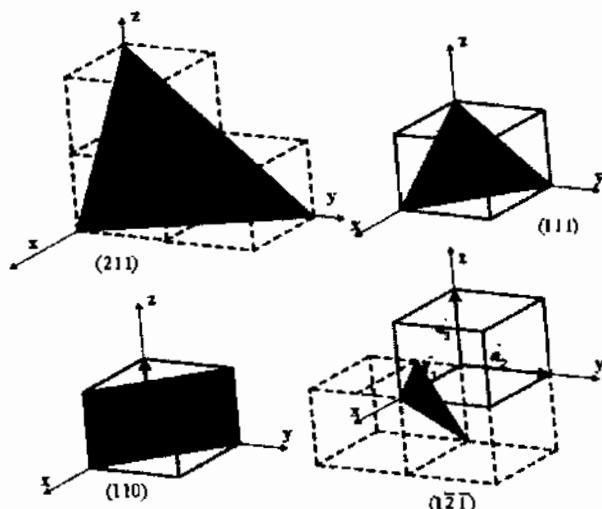
3) ระบุระยะห์รูบนาบทั้งแกน x y z ในหน่วยของ $\bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3$ โดยได้ค่าเป็น

(H_1, K_2, L_3)

4) หากส่วนกลับ $\frac{1}{H} \frac{1}{K} \frac{1}{L}$ โดยทำให้เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด ตัวเลขที่ได้คือ $h k l$

5) จากตัวเลข $h k l$ ที่ได้ตามข้อ 4 เป็นตัวนี้มิลเลอร์ที่ใช้รูบนาบ $h k l$ โดยเขียนในรูปแบบ $(h k l)$ อ่านว่า รูบนาบ $h k l$

ตัวอย่างการระบุรูบนาบ เช่น รูบนาบที่มีจุดตัดแกน x y z ที่ $1a_1 2a_2 2a_3$ ตามลำดับ ในที่นี้ $H=1$ $K=2$ $L=2$ มีส่วนกลับของระยะห์รูบนาบทั้งแกน x y z คือ $\frac{1}{H} = \frac{1}{1}, \frac{1}{K} = \frac{1}{2}, \frac{1}{L} = \frac{1}{2}$ ทำให้เป็น จำนวนเต็มน้อยที่สุด โดยการคูณด้วย 2 จะได้ชุดตัวเลข $2 1 1$ นั่นคือ ให้ค่า $h=2$ $k=1$ $l=1$ ตั้งนั้น ตัวนี้มิลเลอร์ สำหรับรูบนาบนี้ คือ (211) การอ้างถึงรูบนาบโดยทั่วไปจะใช้คำว่า “รูบนาบ” ตามด้วย ตัวนี้มิลเลอร์ เช่น รูบนาบ (211) เป็นต้น ดังภาพที่ 2.5 แสดงรูบนาบ (211) พร้อมกับยกตัวอย่าง รูบนาบอื่นๆ [8]



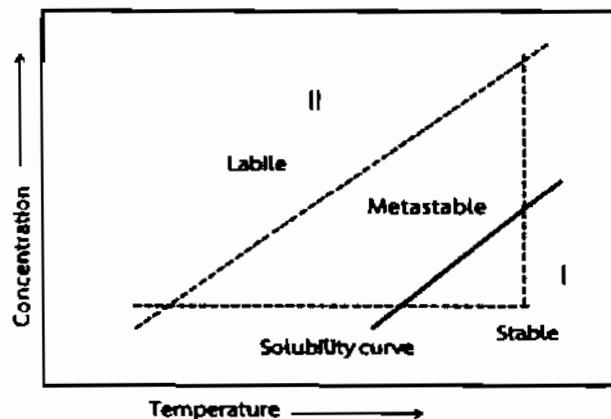
ภาพที่ 2.5 รูบนาบ (211) (111) (110) (1-2-1) [8]

2.2 เทคนิคการปลูกผลึกจากสารละลาย

การปลูกผลึกจากสารละลายมีหลายวิธี ซึ่งโครงงานนี้ใช้วิธีการปลูกผลึกจากสารละลาย โดยแบ่งเป็นสองแบบ คือ วิธีปลูกแบบตั้งเดิมและแบบทิศทางเดียว

2.2.1 การปัลอกผลึกแบบตั้งเดิมจากสารละลาย

การปัลอกผลึกจากสารละลายเป็นการนำสารที่ต้องการทำให้เกิดผลึก ไปละลายในตัวทำละลาย จนกระทั่งได้สารละลายอิ่มตัว แล้วปล่อยให้ตัวทำละลายเกิดการระเหยอย่างช้าๆ จากนั้นสารละลายจะเกิดการอิ่มตัวยิ่งขวด โดยสารจะสารแยกตัวออกจากสารละลายในรูปของแข็ง กระบวนการนี้เรียกว่า การตกผลึก (crystallization) และสารละลายอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในสารละลายเรียกว่า mother liquor

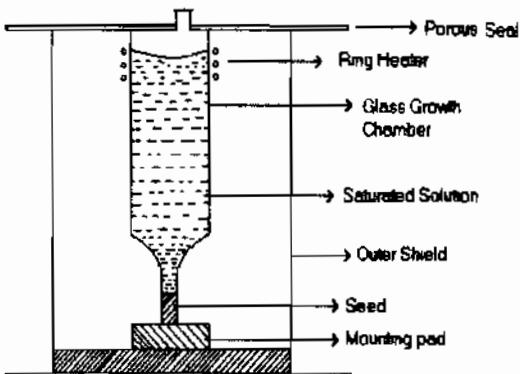


ภาพที่ 2.6 ความสามารถในการละลายของสารโดยทั่วไป [9]

การปัลอกผลึกจากสารละลายสามารถทำได้โดยการควบคุมอุณหภูมิ และความเข้มข้นของสารละลายให้อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า บริเวณ metestable zone จากภาพที่ 2.6 จะเห็นว่า กราฟความเข้มข้นของสารละลายถูกแบ่งออกเป็นสองบริเวณด้วยเส้นความเข้มข้นสูงสุด (solubility curve) ที่อุณหภูมิต่างๆ ผลึกจะไม่สามารถเกิดในบริเวณที่ต่ำกว่าเส้นความสามารถในการละลายได้ เพราะสารละลายในบริเวณนี้ยังไม่เกิดการอิ่มตัว สำหรับจุดที่อยู่บนเส้นความเข้มข้นสูงสุด เป็นบริเวณที่สารละลายอิ่มตัว มีการเกิดผลึกและการละลายของสารสมดุลกัน ผลึกจึงไม่มีการเจริญเติบโต ส่วนบริเวณที่อยู่เหนือเส้นความเข้มข้นสูงสุด เป็นบริเวณที่สารละลายเกิดความอิ่มตัวยิ่งขวด ผลึกจึงสามารถเจริญเติบโตได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองบริเวณคือ labile zone เป็นบริเวณที่ผลึกเกิดขึ้นโดยไม่สามารถควบคุมลักษณะของการเกิดได้ และบริเวณ metestable zone ซึ่งเป็นบริเวณที่ผลึกเกิดขึ้นได้มีอุบัติการณ์ตันจากภายนอก โดยปกตินิยมใช้ชีดหรือผลึกขนาดเล็กมาเห็นยาน้ำให้เกิดต่อเนื่องจากผลึกตั้งกล่าว ตั้งนี้ จึงสามารถควบคุมการเกิดผลึกในบริเวณนี้ได้โดยการควบคุมอุณหภูมิกับความเข้มข้นที่เหมาะสม

2.2.2 การปัลอกผลึกแบบทิศทางเดียว (SR)

จากการศึกษาของ Sankaranarayanan และ Ramasamy [9] พบว่าสามารถเลือกระนาบและทิศทางการเกิดของผลึกได้ โดยการบังคับทิศทางการเจริญเติบโตของผลึก วิธีการนี้เรียกว่า การปัลอกผลึกแบบทิศทางเดียว (Sankaranarayanan- Ramasamy method, SR) อุปกรณ์การปัลอกตัวยิ่งนี้ ถูกแสดงดังภาพที่ 2.7



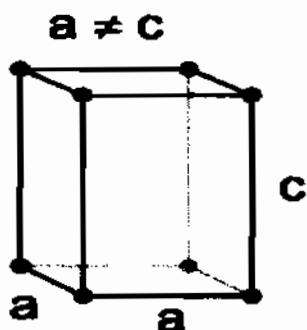
ภาพที่ 2.7 การปัลกผลึกแบบทิศทางเดียว

จากภาพที่ 2.7 แสดงวิธีการปัลกผลึกแบบทิศทางเดียว โดยการปัลกผลึกสามารถเลือกกระบวนการของซีดมาเป็นตัวหนึ่งในการเจริญเติบโตของผลึก ทำให้ผลึกเจริญเติบโตในระนาบหรือทิศทางที่ต้องการ โดยน้ำซึ่ดไปวางไว้ด้านล่างของหลอดทดลอง จากนั้นใช้วิธีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้เกิดสภาวะอันดับยังไงในบริเวณผิวสัมผัสกับซีด โดยใช้ขดลวดความร้อนควบคุมอุณหภูมิให้บริเวณด้านบนมีอุณหภูมิสูง ในขณะที่บริเวณด้านล่าง (เน้นซีด) มีอุณหภูมิต่ำ ผลึกจะค่อยๆ เกิดตามระนาบหรือทิศทางของซีด การปัลกผลึกจากสารละลายด้วยเทคนิคการปัลกผลึกแบบทิศทางเดียวได้รับความนิยมแพร่หลาย เพราะสามารถนำไปใช้ปัลกผลึกเชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น และผลึกของสารอื่นๆ ได้ผลึกคุณภาพสูงที่มีต้นทุนต่ำ ในปัจจุบันเทคนิคการปัลกผลึกแบบทิศทางเดียว ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อปัลกผลึกเดียวของสารชนิดต่างๆ ผลึกที่ปัลกด้วยวิธีนี้มีคุณภาพที่ดีซึ่ง ทั้งสมบัติทางแสงและลักษณะทางกายภาพ [10, 11]

2.3 สารเคมี

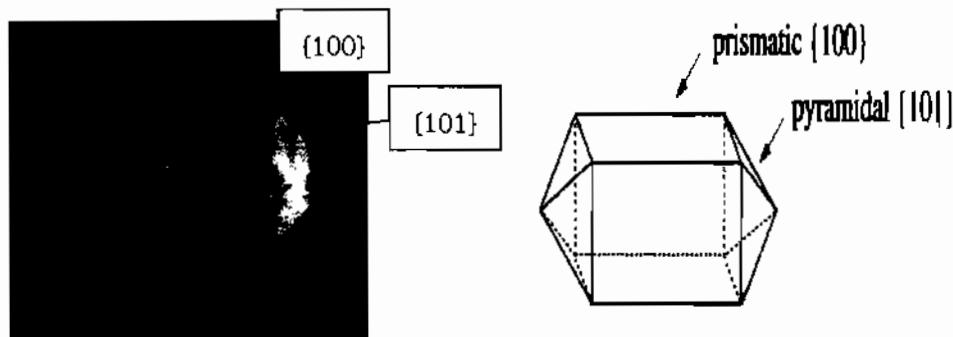
2.3.1 โพแทสเซียมไนโตรเจนฟอสเฟต

โพแทสเซียมไดไฮดรอเจนฟอสเฟต เป็นสารอินทรีย์มีสูตรโมเลกุลคือ KH_2PO_4 ลักษณะเป็นเม็ดสีขาว ในสภาวะที่เป็นสารละลายมีค่า pH อยู่ในช่วง 4.2-4.7 เป็นสารที่ไม่มีความสมมาตรในผลึกซึ่งส่งผลต่อสมบัติไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของผลึก KDP [12]



ภาพที่ 2.8 โครงสร้างผลึกแบบเขตระบุนอล [12]

ผลึก KDP ประกอบด้วยไอออนบวก ไอออนลบ และพันธะไฮโดรเจน มีลักษณะโครงสร้าง ผลึกแบบเตต拉โนโนอล ดังภาพที่ 2.8 โดยหน่วยเซลล์มีความยาวของแกน a และแกน b เท่ากับ 7.44656 \AA แต่แกน c มีค่าความยาวเท่ากับ 7.04645 \AA มุมระหว่างแกน (α β γ) ทำมุมต่อกัน 90° [12] ในปัจจุบันผลึก KDP ได้รับความสนใจเนื่องจากสมบัติต่างๆ เช่น สมบัติเพอร์โอะลีเอ็กทริก และสมบัติความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสง ที่เหมาะสมสำหรับการแปลงความถี่สารโนนิคที่สูงขึ้นของระบบเลเซอร์ โดยลรังษารามโนนิกที่สองและสามจากความถี่พื้นฐาน นอกจากนี้ ความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของผลึก KDP ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการตอบสนองลักษณะทางแสงของผลึกอื่นๆ อีกด้วย [13]

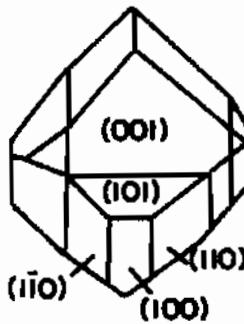


ภาพที่ 2.9 ลักษณะอัณฑูตของผลึก KDP [13]

การปัลส์ผลึก KDP โดยทั่วไปนิยมปัลส์ในทิศทาง $<100>$ และ $<101>$ ดังภาพที่ 2.9 เพราะทิศทางตั้งกับล่ามสามารถปัลส์ได้ง่าย และมีอัตราการเจริญเติบโตของผลึกสูง จากการศึกษาของ Sankaranarayanan และ Ramasamy พบร่วมกัน วิธีการปัลส์ผลึกแบบทิศทางเดียว เหมาะสมสำหรับการปัลส์ผลึกเดียวที่ไม่เป็นเชิงเส้นทางแสง [9]

2.3.2 ไตรไกลซีนชัลเฟต

ไตรไกลซีนชัลเฟต มีสูตรโมเลกุลคือ $(\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH})_3\text{H}_2\text{SO}_4$ เกิดจากการสร้างพันธะระหว่างไกลซีนและกรดชัลฟูริก ในอัตราส่วน 3:1 โครงสร้างผลึกไตรไกลซีนชัลเฟต เป็นแบบไมโน่คลินิก ตามหลักการของบราร์ดส์ ดังภาพที่ 2.10 หน่วยเซลล์มีความยาวของแกนไม่เท่ากัน โดยแกน a มีค่าเท่ากับ 0.9417 \AA แกน b มีค่าเท่ากับ 1.2643 \AA และแกน c มีค่าเท่ากับ 0.5735 \AA มุม α และ γ มีค่าเท่ากับ 90° แต่มุม β ทำมุมไม่เท่ากับ 90° [14] ผลึก TGS มีสมบัติเด่นในด้านเพอร์โอะลีเอ็กทริก [6] จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ยาร์ดดิส เป็นต้น



ภาพที่ 2.10 ลักษณะผลึกไตรไกลซีนชั้นเพด [14]

2.4 เทคนิคการวิเคราะห์สมบัติของผลึก

2.4.1 เทคนิคเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

เทคนิคเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึกเพื่อดูการจัดเรียงตัวของอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบด่างๆ โดยสามารถใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารประกอบภายในโครงสร้างผลึก ได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยปรากฏการณ์เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามกฎของแบรนก์

ปรากฏการณ์เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ในโครงสร้างผลึกเกิดขึ้นลักษณะเดียวกับการสะท้อนของแสงบนกระดาษรับ เพราะอะตอมในผลึกจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ มีชุดระนาบของอะตอมที่เหมือนกัน ห่างกันด้วยระยะทางที่เท่ากัน ทำให้เกิดระนาบการสะท้อนขึ้นในโครงสร้างผลึก รังสีเอกซ์ได้จากการให้กระแสไฟฟ้าที่ข้าวแครอท แล้วทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมานอกเร่งจากความต่างศักย์ระหว่างข้าวแครอทและแอนโโนด เพื่อให้อิเล็กตรอนจากข้าวแครอทวิ่งเข้าชนเป้าที่ชั้วแอนโโนด ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมานา

เมื่อนำรังสีเอกซ์มาจ่ายลงบนผลึกที่ต้องการศึกษา ลำรังสีเอกซ์ส่วนใหญ่ผ่านผลึกไปได้โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่บางส่วนสะท้อนและกระจายออกไปในหลายทิศทางแล้วเป็นรูปแบบที่ไม่ต่อเนื่อง มุมของรังสีเอกซ์ที่สะท้อนออกมานะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดครูป่างและสมมาตรของหน่วยเซลล์และพบการเกิด漉漉ลายการเลี้ยวเบนขึ้น รังสีเอกซ์ที่สะท้อนออกจากระนาบชุดหนึ่ง จะแทรกสอดแบบเสริมกัน เมื่อระยะทางแต่ละลำรังสีที่ตกลงบนระนาบ มีความแตกต่างกันเป็นจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ ดังความสัมพันธ์ในสมการที่ 2.1

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (2.1)$$

เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างระนาบ

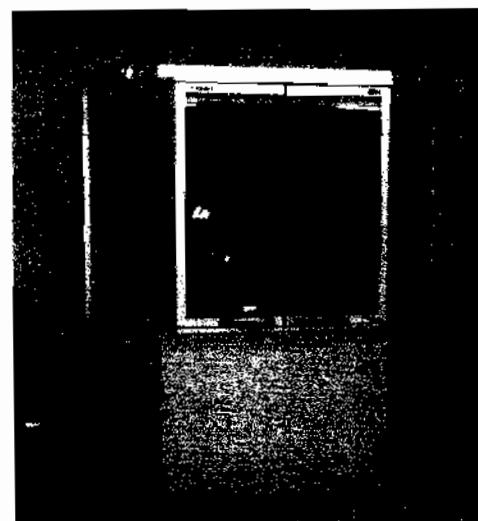
θ คือ มุมสะท้อนจากระนาบของอะตอมซึ่งเท่ากับมุมตกกระทบ

λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์

เมื่อใช้รังสีเอกซ์ที่มีความยาวคลื่นใกล้เคียงกับระยะห่างของอะตอมภายในผลึกและหมุนผลึกทามุมต่างๆ กับแสงที่ตกกระทบ จะทำให้ได้รูปแบบการเลี้ยวเบน การหมุนผลึกจะทำให้ได้ข้อมูลจาก

การเลี้ยวเบนที่มุมต่างๆ การวัดสเปกตรัมของสารตัวอย่างจะมุนผลลัพธ์เป็นมุม θ ขณะที่อุปกรณ์การตรวจวัดสัญญาณรังสีเอกซ์จะหมุนเป็นมุม 2θ ตามหลักการเลี้ยวเบนของแบบราก

ในทางปฏิบัติ นิยมเตรียมสารตัวอย่างจากผงของผลลัพธ์เดียว ทำให้ขั้นสารตัวอย่างประกอบขึ้นจากผลลัพธ์เดียว จำนวนมาก และจัดเรียงตัวอย่างสุ่ม ทำให้แต่ละรูปแบบ hkl มีตำแหน่งแตกต่างกัน ข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ถูกแสดงเป็นเส้นสเปกตรัมความเข้มของรังสีที่สะท้อนออกมากับมุม θ ทำการวัด เมื่อได้ค่า θ จะทำการคำนวณหาค่าระยะห่างระหว่างรูปแบบ (d) ได้ตามสมการของแบบราก และสามารถตอบอกโครงสร้างผลลัพธ์จากรูปแบบที่เกิดขึ้น โดยนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน JCPDS (joint committee on powder diffraction standard) หรือเทียบกับสเปกตรัมจากงานวิจัยต่างๆ [15] ตัวอย่างเครื่อง Bruker's X-ray diffraction D8-discover แสดงดังภาพที่ 2.11



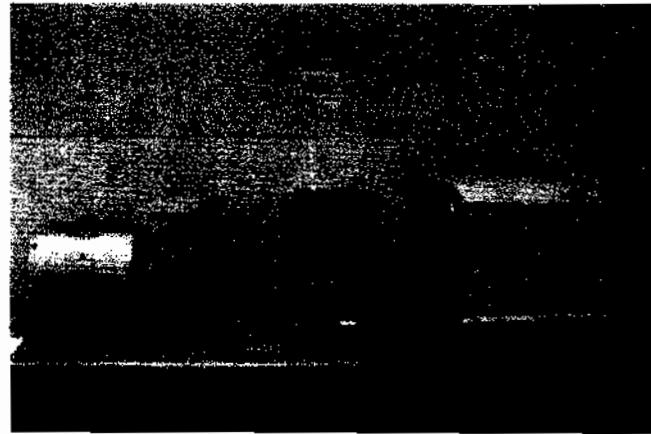
ภาพที่ 2.11 เครื่อง Bruker's X-ray diffraction D8-discover [16]

2.4.2 การศึกษานมผึ้งก์ชันโดยใช้เทคนิค FT-IR

เทคนิค FT-IR เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์พันธะของโมเลกุลต่างๆ โดยพันธะเหล่านี้ สามารถแสดงถึงนมผึ้งก์ชันของโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบของผลลัพธ์ เทคนิคนี้สามารถใช้วิเคราะห์ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ เป็นวิธีการวิเคราะห์ด้วยแสงเทคนิคนี้ โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงกับพันธะในโมเลกุลของผลลัพธ์ เทคนิคนี้จะใช้แสงในย่านความถี่อินฟราเรด ที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ 0.78-1000 nm แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ อินฟราเรดย่านไกล อินฟราเรดย่านกลาง และ อินฟราเรดย่านใกล้ โดยช่วงเลขคลื่น 4000 - 400 cm⁻¹ เป็นช่วงที่แสดงถึงพันธะของโมเลกุล ได้แก่ C=O O-H C-O N-H เป็นต้น

ในช่วงเลขคลื่น 1500 – 400 cm⁻¹ เป็นช่วง fingerprint region มีลักษณะการแสดงสเปกตรัมการคูณกลืนเฉพาะของสารแต่ละชนิด โดยปกติสเปกตรัมในช่วงนี้จะซับซ้อน ดังนั้น การวิเคราะห์สเปกตรัมจึงอ้างอิงจากเอกสารวิจัยหรือไฟล์อ้างอิงมาตรฐาน จากนั้น เปรียบเทียบยอดการคูณกลืนของสเปกตรัมที่จากการวัด เพื่อวิเคราะห์พันธะของนมผึ้งก์ชัน [17] โครงงานนี้ใช้เครื่อง

PERKIN ELMER spectrum GX FT-IR system ดังภาพที่ 2.12 ตั้งอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือกลัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ภาพที่ 2.12 เครื่อง PERKIN ELMER spectrum GX FT-IR system

2.4.3 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

SEM เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่ใช้ถ่ายภาพพื้นผิวของชิ้นงาน การเตรียมชิ้นงานในกรณีที่ชิ้นสารตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า จะต้องปรับสภาพความนำไฟฟ้าที่ผิวของตัวอย่างให้สามารถนำไฟฟ้าได้ดี ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียบง่ายนิยมใช้การเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิค สปัตเตอร์ริง (sputtering) โดยที่จะไปนิยมเคลือบทองหรือคาร์บอน ซึ่งต้องเลือกชนิดของฟิล์มให้เหมาะสมกับชิ้นงาน อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ปรับสภาพความนำไฟฟ้าที่ผิวของผลึก KDP โดยการเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นสาร ตัวอย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสะสมของอิเล็กตรอนที่ผิวของชิ้นตัวอย่าง ในขณะทำการถ่ายภาพ

ภาพที่ได้จากการถ่าย SEM จะแสดงในลักษณะ 3 มิติ โดยเกิดจากการวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจากพื้นผิวน้ำของตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบ โดยแหล่งกำเนิดของอิเล็กตรอนที่ข้ามแคโทด คือ ขดลวดทั้งสอง ทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอน จากนั้นอิเล็กตรอนจะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าในช่วง 1 – 40 KV ให้วิ่งเป็นล้ำผ่าน condenser lens เพื่อปรับขนาดลำอิเล็กตรอน และปรับโฟกัสด้วย objective lens ถ้าต้องการให้ล้ำอิเล็กตรอนกว้างไปทั่วผิวของตัวอย่าง สามารถควบคุมได้โดยใช้ scanning coils เพื่อให้ล้ำอิเล็กตรอนกว้างบนระนาบ x-y

เมื่อล้ำอิเล็กตรอนกระทบลงบนผิวของชิ้นสารตัวอย่าง จะทำให้เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวของชิ้นสารตัวอย่าง ซึ่งเกิดจากล้ำอิเล็กตรอนถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนของอะตอมชิ้นสาร ตัวอย่าง เครื่อง SEM จะรวมอิเล็กตรอนที่หลุดออกมากจากผิวของสารตัวอย่าง แล้วเอาสัญญาณไปประมวลผล เพื่อสร้างภาพถ่ายพื้นผิวของชิ้นสารตัวอย่างบนจอ CRT [18] โครงการนี้ใช้เครื่อง SEM ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-6460LV ดังภาพที่ 2.13 ตั้งอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือกลัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ภาพที่ 2.13 เครื่อง SEM รุ่น JEOL JSM-6460LV

2.4.4 สมบัติโดยอิเล็กทริก

นักวิทยาศาสตร์ชื่อ ฟาราเดย์ ได้คิดสร้างตัวเก็บประจุที่มีลักษณะเหมือนกับทุกประการขึ้นมา สองตัว โดยช่องว่างระหว่างนานของตัวเก็บประจุตัวแรก คือ อากาศ และตัวเก็บประจุตัวที่สอง คือ ไดอิเล็กทริกชนิดหนึ่ง ผ่านตัวเก็บประจุทั้งสองได้รับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน พบว่าประจุบนตัวเก็บประจุของสารไดอิเล็กทริกคัน率ระหว่างแผ่นนานจะมีค่าสูงกว่าประจุบนตัวเก็บประจุของอากาศ ระหว่างแผ่นนาน

ไดอิเล็กทริก เป็นสมบัติหนึ่งของอนุวนไฟฟ้า เมื่อนำมาคัน率ระหว่างแผ่นตัวนำในตัวเก็บประจุ จะทำให้สามารถเก็บสะสมพลังงานในรูปสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำได้ โดยจะทำให้เกิดการเรียงตัวของโพลาไรเซชันขึ้นภายในเนื้อสารไดอิเล็กทริก ทำให้เกิดโครงสร้างของตัวเก็บประจุขึ้น ค่าความเก็บประจุจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสารที่คัน率ระหว่างแผ่นตัวนำตามการทดลองของฟาราเดย์ ดังนั้น การศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสารต่างๆ รวมถึงค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก สามารถทำได้โดยการวัดค่าตัวเก็บประจุของสารนั้นๆ ที่ค่าสนามไฟฟ้าต่างๆ วัดได้จากวงจร RLC โดยโครงงานนี้ใช้ชั้นสารตัวอย่างที่มีสมบัติไม่นำไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการทดสอบค่าคงที่ไดอิเล็กทริก เมื่อนำมา วัดระหว่างตัวเก็บประจุ ดังแสดงในภาพที่ 2.14



ภาพที่ 2.14 เครื่อง Agilent E4980A

กรณีที่จ่ายความต่างศักยไฟฟ้าให้กับตัวเก็บประจุเท่ากัน ความสามารถในการเก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า (ประจุ) จะขึ้นกับค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่คั่นระหว่างแผ่นด้านบน โดยค่าความเก็บประจุมีความสัมพันธ์กับศักยไฟฟ้าจากภายนอก ดังแสดงในสมการที่ 2.2

$$C = \frac{q}{V_{ab}} \quad (2.2)$$

$$C = \frac{\epsilon A}{d} \quad (2.3)$$

โดยที่ C คือ ค่าความจุไฟฟ้า

q คือ ประจุไฟฟ้า

V_{ab} คือ ศักยไฟฟาระหว่างจุด a และจุด b

ϵ คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก

A คือ พื้นที่ของแผ่นด้านบน

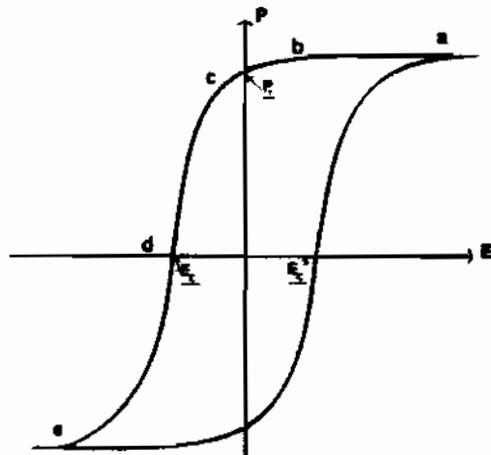
d คือ ความหนาของสารไดอิเล็กทริก

สมการที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเก็บประจุกับค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ซึ่งสอดคล้องการทดลองของฟาราเดีย เห็นได้ว่าความจุของตัวเก็บประจุใดๆ มีค่าเพิ่มขึ้นถ้าตัวเก็บประจุนั้นมีไดอิเล็กทริกคั่นระหว่างแผ่นนานทั้งสอง อัตราส่วนระหว่างความจุของตัวเก็บประจุใดๆ เมื่อไดอิเล็กทริกคั่น (ϵ) กับไม่มีไดอิเล็กทริกคั่น (ϵ_0) เรียกว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ (ϵ_r) ดังแสดงในสมการที่ 2.4 [19]

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (2.4)$$

2.4.5 สมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก

เฟอร์โรอิเล็กทริก คือ สมบัติที่มีโมเมนต์ทางไฟฟ้าแม่ว่าไม่มีสนามไฟฟ้าจากภายนอก สารที่มีสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกจะประกอบขึ้นจากโดยเมนไดโอลามีเมนต์ดาวร ทิศทางของไดโอลจะเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในแต่ละโดเมน อย่างไรก็ตาม โดยเมนมีทิศทางแบบสุ่ม ทำให้มีค่าโพลาไรเซชันสูง เมื่อให้สนามไฟฟ้าจากภายนอกเข้ากระตุนการจัดเรียงตัวของโดยเมนเหล่านี้ จะทำให้โดยเมนเกิดเรียงตัวไปด้านทิศทางของสนามไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบ จึงเกิดโพลาไรเซชันสูงขึ้น แม้ว่าจะหยุดจ่ายสนามไฟฟ้าจากภายนอก โดยเมนเหล่านี้จะยังคงเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบภายในเนื้อสาร ทำให้เกิดโพลาไรเซชันคงเหลือ



ภาพที่ 2.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง E-P ของเฟอร์โรอิเล็กทริก [20]

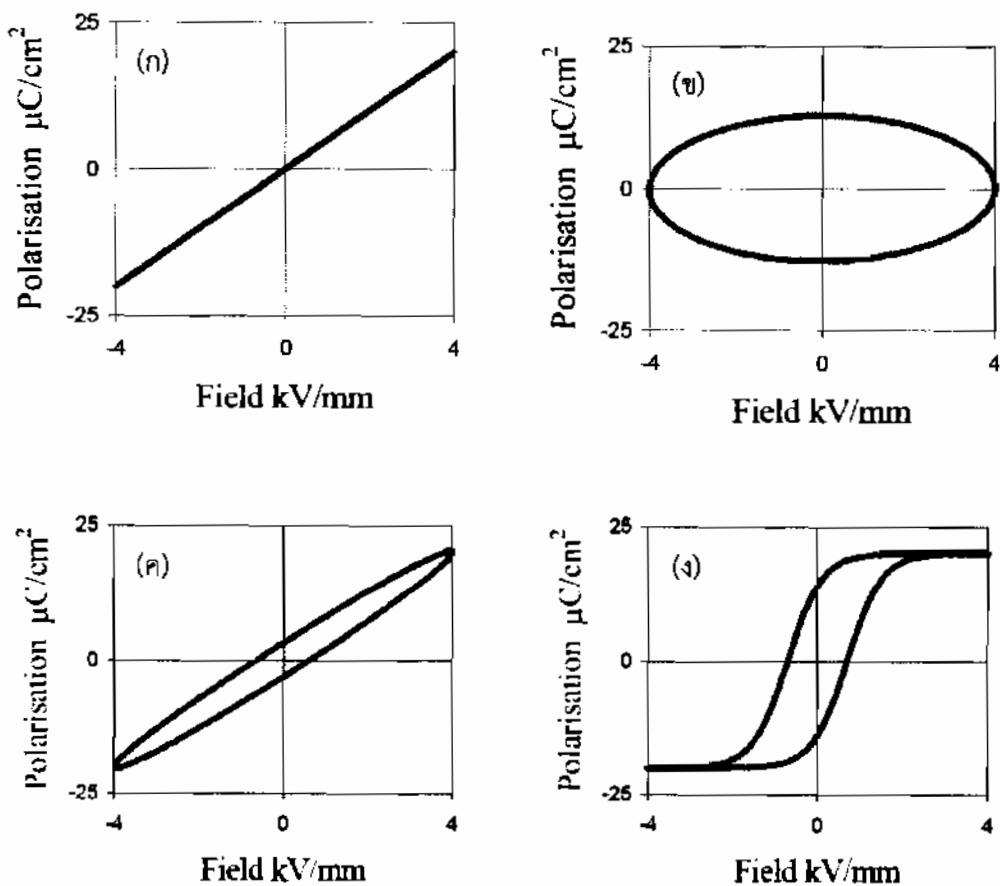
จากภาพที่ 2.15 แสดงให้เห็นว่า เมื่อ $E = -E_c$ สารมีโมเมนต์ข้ามคู่กับการ อาจกล่าวได้ว่าสารนี้แสดงสถานะเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริก แต่อย่างไรก็ตาม พลังงานความร้อนสามารถทำลายการจัดเรียงตัวของโดยเมนได้ ดังนี้ สารเฟอร์โรอิเล็กทริกจะแสดงสมบัติได้ดังภาพที่ 2.15 จะต้องอยู่ในสภาวะที่พลังงานความร้อนไม่มากพอที่จะทำลายการจัดเรียงตัวของโดยเมนภายในเนื้อสาร ซึ่งเรียกอุณหภูมิสูงสุดที่สารยังคงสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกได้ ว่า อุณหภูมิวิกฤติ (T_c) ซึ่งในสภาวะที่อุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิวิกฤติ ผลึกจะอยู่ในสถานะ พาราอิเล็กทริก [21]

สำหรับการศึกษาการเกิดโพลาไรเซชัน ผลที่ได้จะแสดงในรูปกราฟระหว่าง ค่าสนามไฟฟ้าจากภายนอกกับโพลาไรเซชัน โดยตัวอย่างกราฟลักษณะสมบัติของอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม แสดงดังภาพที่ 2.16 ดังนี้

- (ก) กราฟลักษณะสมบัติของตัวเก็บประจุในอุตสาหกรรม เช่น ซึ่งเป็นตัวเก็บประจุเชิงเส้นที่เป็นเส้นตรงมีสัดส่วนความชันกับค่าความจุไฟฟ้า
- (ข) กราฟลักษณะสมบัติของตัวด้านหนานในอุตสาหกรรม เชิงเส้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีการสะสมพลังงานในรูปสนามไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก

(ค) กราฟลักษณะสมบัติของการสูญเสียตัวเก็บประจุเชิงเส้น ซึ่งเป็นผลจากการสูญเสียประจุในพื้นที่ภายในสูปที่มี สัดส่วนสัมผัสของอุปกรณ์ทำให้เกิดการสูญเสียและมีสัดส่วนความชันกับค่าความจุไฟฟ้า

(ง) การตอบสนองแบบบันไดเป็นเชิงเส้นของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก ซึ่งมีโมเลกุลเรียงตัวกันได้เองโดยไม่ต้องใช้สนามไฟฟ้าจากภายนอก



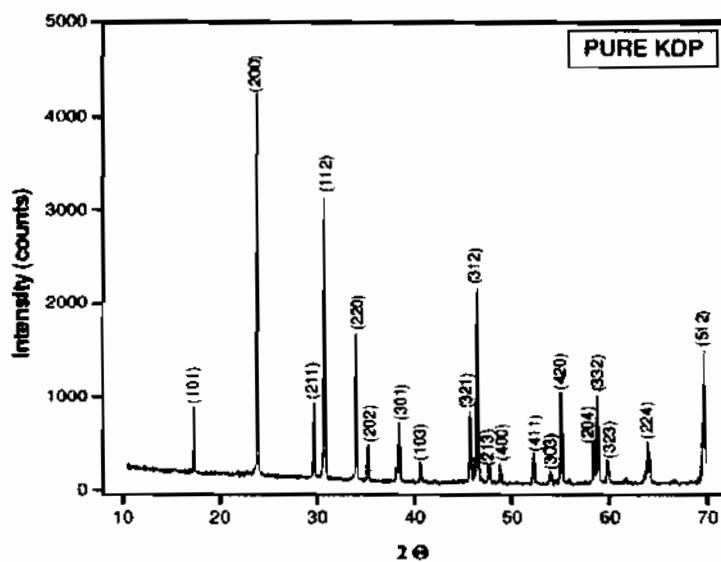
ภาพที่ 2.16 ความสัมพันธ์ระหว่าง E-P ของเครื่องมือวัด [22]

- (ก) กราฟลักษณะสมบัติของการสูญเสียตัวเก็บประจุในอุดมคติแบบเชิงเส้น
- (ข) กราฟลักษณะสมบัติของการสูญเสียตัวต้านทานในอุดมคติแบบเชิงเส้น
- (ค) กราฟลักษณะสมบัติของการสูญเสียตัวเก็บประจุแบบเชิงเส้น
- (ง) กราฟลักษณะสมบัติของการสูญเสียตัวไฟฟ้าแบบบันไดเป็นเชิงเส้น

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

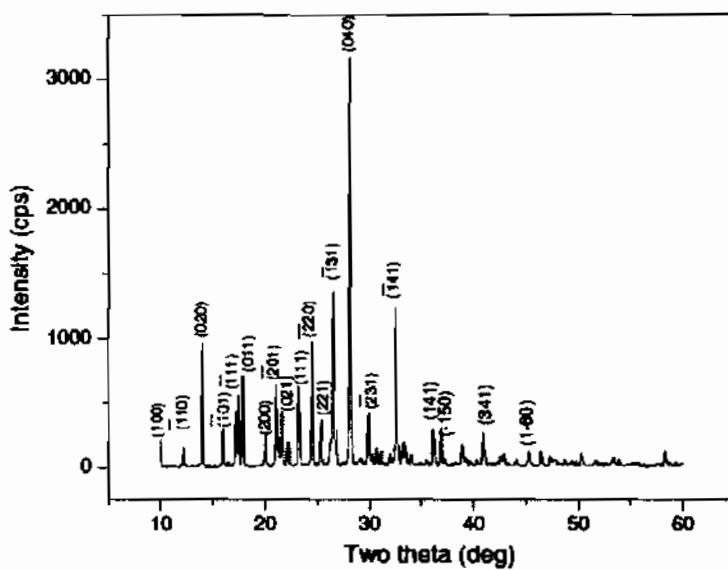
การศึกษาสมบัติของผลึก KDP และผลึก TGS มีการรายงานในงานวิจัยต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งการทำโครงงานครั้งนี้ได้ยกเอางานวิจัยที่เกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของผลึก KDP และผลึก TGS เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและแนวทางในการวิเคราะห์สมบัติของผลึกที่ปัจุกได้

Loretta และคณะได้ศึกษาスペกตรัมการเลือยาเบนของรังสีเอกซ์ เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก โดยดูการจัดเรียงตัวของอะตอมหรือโมเลกุลของของผลึกโพแทสเซียมไดออกโนฟอสเฟต [23] เมื่อวิเคราะห์เส้นスペกตรัมการเลือยาเบน จะสังเกตเห็นยอดปราภรขึ้นที่มุม $2\theta = 27^\circ$ ต่างๆ คือ ยอดของ ระยะนาบ (101) (200) (112) ซึ่งแสดงถึงรูปแบบโครงสร้างผลึกแบบเตตราゴโนลดของผลึก KDP อย่างชัดเจนดังภาพที่ 2.17



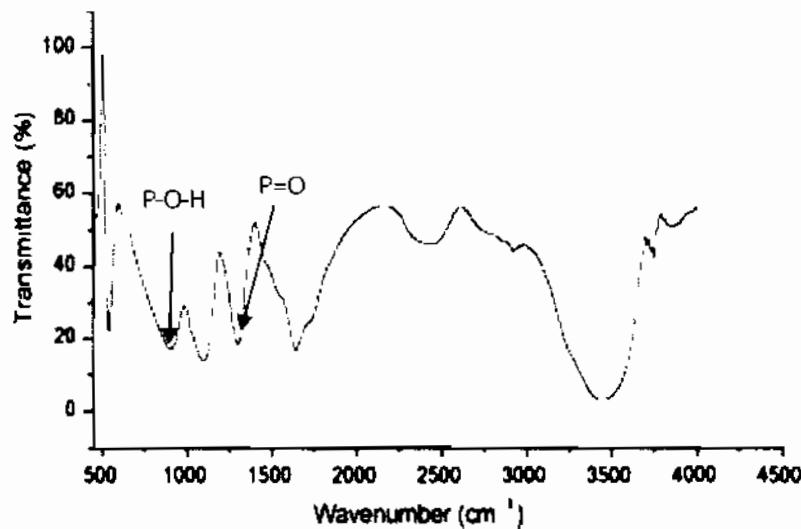
ภาพที่ 2.17 สเปกตรัมรูปแบบต่างๆ ของผลึก KDP [23]

การศึกษาโครงสร้างผลึกเพื่อดูการจัดเรียงตัวของอะตอมหรือโมเลกุลของของผลึก TGS [24] พบร่วมยอดของระยะนาบต่างๆ ปราภรขึ้นที่มุม 2θ ในช่วง 10° - 40° ได้แก่ ระยะนาบ (020) (100) (040) และ (-131) โดยแสดงถึงรูปแบบโครงสร้างผลึกแบบไม่ในคลินิกของผลึก TGS อย่างชัดเจนดังภาพที่ 2.18



ภาพที่ 2.18 สเปกตรัมรูปแบบต่างๆ ของผลึก TGS [24]

จากการวิจัยของ Balamurugan และ Ramasamy [7] เป็นการศึกษาสมบัติของผลึก KDP ซึ่งเป็นการปลูกผลึกจากสารละลายแบบดึงเดิมและแบบหักทางเดียว โดยวิธี SR โดยเลือกหักทางการปลูกคือ <100> จากนั้นเปรียบเทียบสมบัติที่ได้จากหักสองวิธี โดยใช้เทคนิค FT-IR เพื่อการศึกษาหมุนฟังก์ชันของผลึก KDP ใช้ช่วงเลขคลื่นดังต่อไปนี้ $500\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$ ผลการศึกษาถูกแสดงดังภาพที่ 2.19

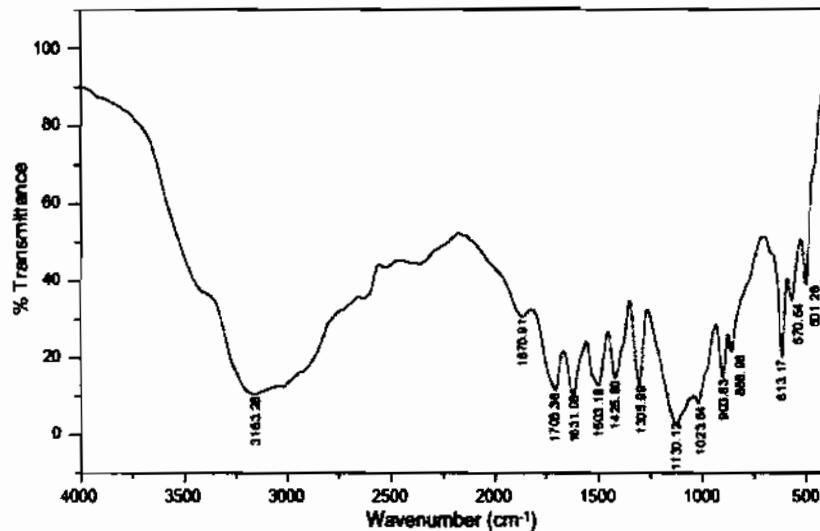


ภาพที่ 2.19 สเปกตรัมการส่งผ่านจากเครื่อง FT-IR ของผลึก KDP [7]

จากการที่ 2.19 สเปกตรัมจากเครื่อง FT-IR ของผลึก KDP พบว่ามีการดูดกลืนแสงอินฟราเรดที่แยกต่างกันในช่วงเลขคลื่น $500\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$ โดยเส้นสเปกตรัมในช่วง $500\text{-}1500\text{ cm}^{-1}$

จะแสดงดึงหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ของผลึก KDP ได้แก่ หมู่ฟังก์ชัน P=O ซึ่งมียอดสเปกตรัม 1303 cm^{-1} หมู่ฟังก์ชันของ P-O-H ที่มียอดสเปกตรัม 905 cm^{-1} เป็นต้น

สำหรับการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของผลึก TGS แสดงดังภาพที่ 2.20 ได้แก่ ยอดสเปกตรัม 613 cm^{-1} แสดงหมู่ฟังก์ชันของ N-H และยอดสเปกตรัมในช่วง $1425\text{-}1503\text{ cm}^{-1}$ แสดงหมู่ฟังก์ชันของ -COOH เป็นต้น [24]



ภาพที่ 2.20 สเปกตรัมการส่งผ่านจากเครื่อง FT-IR ของผลึก TGS [24]

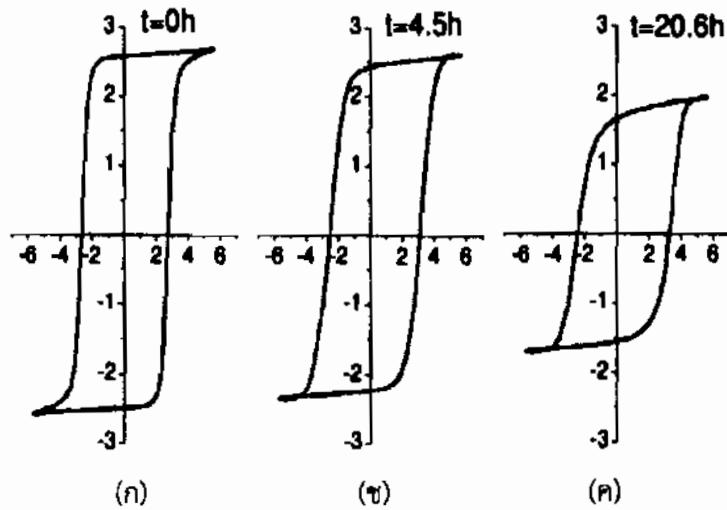
การศึกษาพื้นผิวของผลึก KDP พบว่าพื้นผิวผลึกมีลักษณะเป็นแท่งสีเหลือง มีเหลี่ยมปรากฏที่หัวและท้ายของผลึก ซึ่งลักษณะพื้นผิวของผลึกแสดงดังภาพที่ 2.21 เป็นการปอกผลึก KDP แบบดั้งเดิม ซึ่งโครงงานนี้ใช้เป็นลักษณะรูปทรงมาตรฐานของผลึก KDP ที่ปอกได้ [25]



ภาพที่ 2.21 ลักษณะพื้นผิวของผลึก KDP [25]

สมบัติเพอร์โอเลิกทริกของผลึก TGS ได้ถูกศึกษาอย่างกว้างขวาง เช่น ผลการวัดลักษณะสมบัติการเพลาไรเซชันของผลึก TGS บริสุทธิ์ แสดงดังภาพที่ 2.22 [6] โดยศึกษาเปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชันของผลึก TGS เมื่อได้รับสนามไฟฟ้าเป็นระยะเวลาแตกต่างกันดังแต่ 0 - 20.6 ชั่วโมง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ค่าโพลาไรเซชันมีค่าลดลงเมื่อได้รับสนามไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน



ภาพที่ 2.22 ความสัมพันธ์ค่าโพลาไรเซชันกับค่าสนามไฟฟ้าของผลึก TGS [6]

- (ก) การวัดค่าโพลาไรเซชันกับค่าสนามไฟฟ้าของผลึก TGS ใช้เวลาทดสอบ 0 h
- (ข) การวัดค่าโพลาไรเซชันกับค่าสนามไฟฟ้าของผลึก TGS ใช้เวลาทดสอบ 4.5 h
- (ค) การวัดค่าโพลาไรเซชันกับค่าสนามไฟฟ้าของผลึก TGS ใช้เวลาทดสอบ 20.6 h

บทที่ 3

ขั้นตอนการปููกผลึก

ในบทนี้กล่าวถึงสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปููกผลึก รวมไปถึงกระบวนการปููกผลึก โพแทสเซียมไดไฮดรอเจนฟอสเฟต โดยการปููกแบบดึงเดิมและการปููกผลึกแบบพิศทางเดียว (SR) ทำการเจือด้วยสารไตรไกลซีนซัลเฟต 2% โนล และ 5% โนล เพื่อศึกษาสมบัติต่างๆ ของผลึกดังกล่าว ว่ามีสมบัติเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งรายละเอียดกระบวนการเตรียมและเงื่อนไขที่ใช้ในการศึกษามีดังต่อไปนี้

3.1 อุปกรณ์และสารเคมี

สารเคมีที่ใช้ในโครงงาน

1. โพแทสเซียมไดไฮดรอเจนฟอสเฟต คุณภาพระดับ reagents ความบริสุทธิ์ 99.0% ยี่ห้อ CARLO ERBA REAGENTI ความสามารถการละลายน้ำ 28 g/100 ml ที่อุณหภูมิ 25 °C
2. ไกลซีน คุณภาพระดับ analytical ความบริสุทธิ์ 99.0% ยี่ห้อCARLO ERBA REAGENTI ความสามารถการละลายน้ำ 24.99 g/100 ml ที่อุณหภูมิ 25 °C
3. กรดซัลฟูริก ความเข้มข้น 98.08 g/mol ความเป็นกรด 95-98%
4. น้ำประปาจากไอโอน (deionized water) หรือน้ำดีโอ (DI)

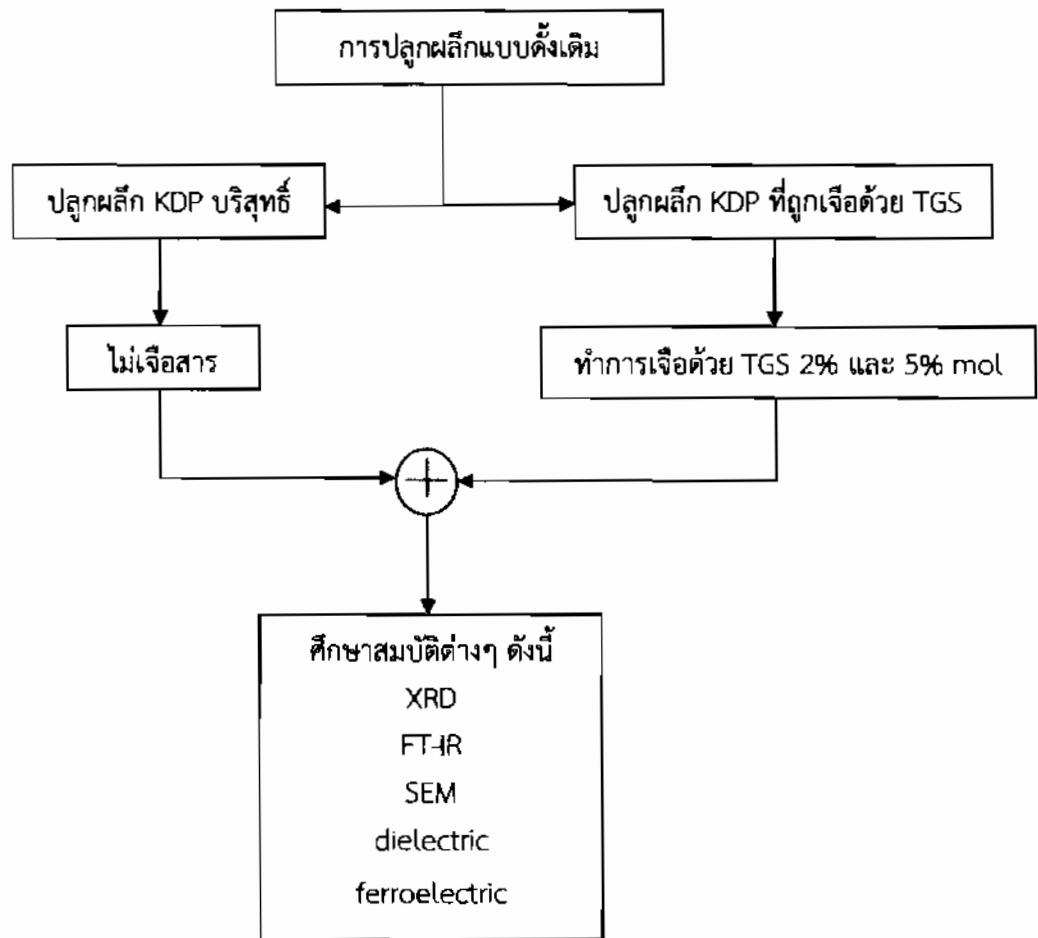
อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน

1. บีกเกอร์
2. อ่างควบคุมอุณหภูมิ
3. หลอดทดลอง
4. ถุงพลาสติก
5. เทอร์โมมิเตอร์ แบบปะอุท
6. เครื่องงานสาร
7. กระดาษกรอง
8. แมกเนติกสเทอร์เรอร์
9. อ่างกระจัก
10. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
11. ข้อมูลสาร
12. โกร่งบดสาร
13. เครื่องซั่งติดต่อความละเอียด 2 ตำแหน่ง
14. เครื่อง XRD รุ่น Bruker's X-ray diffraction D8-discover
15. เครื่อง FT-IR รุ่น PERKIN ELMER spectrum GX FT-IR system
16. เครื่อง SEM รุ่น JEOL JSM-6460LV



17. เครื่อง Agilent E4980A

3.2 แผนผังการดำเนินงานและขั้นตอนการปัลส์กเล็กแบบดึงเดิม



ภาพที่ 3.1 แผนผังการดำเนินงานการปัลส์กเล็กแบบดึงเดิม

จากภาพที่ 3.1 การดำเนินงานการปัลส์กเล็กแบบดึงเดิมโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การปัลส์กเล็ก KDP บริสุทธิ์ และปัลส์กเล็ก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS ด้วยการเจือ 2% mol และ 5% mol เมื่อได้ผลลัพธ์จากการปัลส์แบบดึงเดิมทั้งสองกระบวนการ นำผลลัพธ์ที่ได้ไปศึกษาสมบัติตัวอย่างทางเทคนิค XRD, FT-IR, SEM ศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกและศึกษาสมบัติเพอร์โรมิเตอร์อิเล็กทริก

3.2.1 การปูกรถลีกแบบวิธีตั้งเติม

ตอนที่ 1 ปูกรถลีก KDP บริสุทธิ์ และรถลีก TGS บริสุทธิ์

ตอนที่ 1.1 ปูกรถลีก KDP บริสุทธิ์

1. ล้างบีกเกอร์ด้วยน้ำ DI ทึ้งหมด 2 รอบ
2. ซึ่งสาร KDP ปริมาณ 50 g
3. ทำการละลายสาร KPD ในน้ำ DI ในอัตราส่วน สาร KDP ต่อน้ำ DI ปริมาตร 180 ml
4. เติมสาร KDP ที่เหลืออยู่จนกว่าสารจะหมด
5. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการกรองโดยนำสารละลายที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง
6. นำถุงพลาสติกมาเจาะรู นำไปปิดบีกเกอร์ที่ใช้ใส่สารละลาย แล้วนำไปเก็บที่อ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 35°C ปล่อยให้เกิดการตกผลลัพธ์ร่วมบันทึกผลการทดลอง
7. ทำการเก็บผลลัพธ์และนำไปวิเคราะห์ผล

ตอนที่ 1.2 ปูกรถลีก TGS บริสุทธิ์

1. ล้างบีกเกอร์ด้วยน้ำ DI ทึ้งหมด 2 รอบ
2. เตรียมไกลชีนและกรดซัลฟูริกในอัตราส่วน 3:1 โดยทำการซึ่งสารไกลชีนปริมาณ 45.08 g ใช้กรดซัลฟูริก 11.2 cm^3
3. ทำการละลายสารไกลชีนในน้ำ DI ในอัตราส่วนคือสารไกลชีน 45.08 g ต่อน้ำ DI ปริมาณ 180 ml โดยเติมสารไกลชีนที่เหลืออยู่จนกว่าสารจะหมด
4. เติมกรดซัลฟูริกจำนวนทึ้งหมด 11.2 cm^3 ลงไปที่เหลืออยู่จนกว่าสารจะหมด
5. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการกรอง โดยนำสารละลายที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง
6. นำถุงพลาสติกมาเจาะรู นำไปปิดบีกเกอร์ที่ใช้ใส่สารละลาย แล้วนำไปเก็บที่อ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 35°C ปล่อยให้เกิดการตกผลลัพธ์ร่วมบันทึกผลการทดลอง
7. ทำการเก็บผลลัพธ์และนำไปวิเคราะห์ผล

ตอนที่ 2 ปูกรถลีก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS

ตอนที่ 2.1 ปูกรถลีก KDP โดยการเจือ TGS 2% mol

1. ล้างบีกเกอร์ด้วยน้ำ DI ทึ้งหมด 2 รอบ
2. นำผลลัพธ์ KDP และรถลีก TGS ที่ปูกรถลีกในขั้นตอนที่ 1 มาบดให้ละเอียด โดยผ่านกระบวนการ recrystallization จำนวนทึ้งหมด 2 ครั้ง
3. ซึ่งสาร KDP ที่ได้จากการบดละเอียดปริมาณ 50 g
4. ทำการละลายสาร KPD ในน้ำ DI ในอัตราส่วน สาร KDP 50 g ต่อน้ำ DI ปริมาณ 180 ml โดยเติมสารที่เหลืออยู่จนกว่าสารจะหมด
5. ทำการเจือสาร TGS โดยซึ่งสารปริมาณ 2.37 g (จากการคำนวณในภาคผนวก ก)

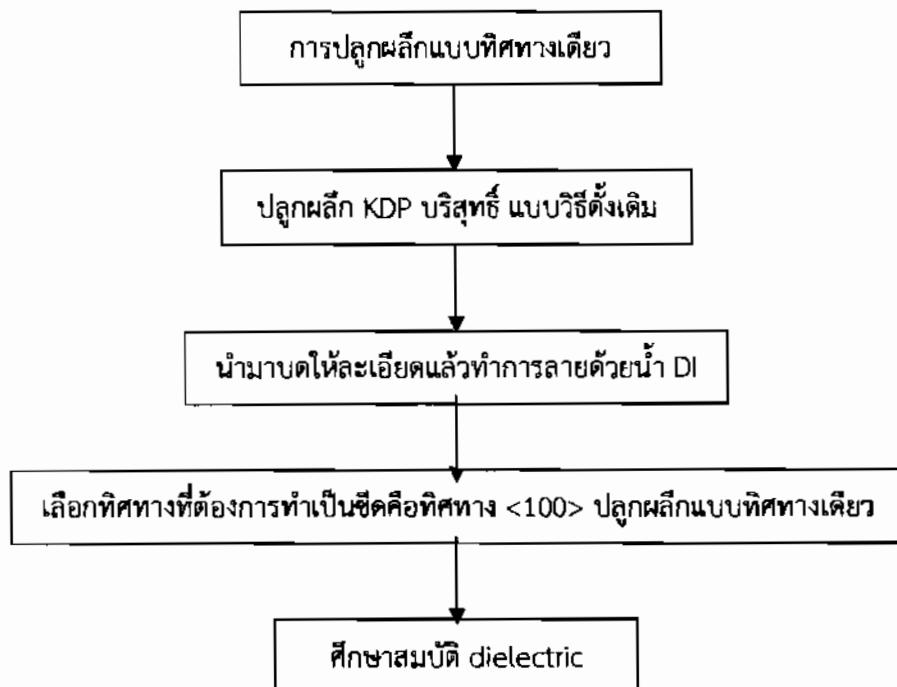


6. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการกรองโดยนำสารละลายที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง
7. นำถุงพลาสติกมาเจาะรู นำไปปิดบีกเกอร์ที่ใช้ใส่สารละลาย แล้วนำไปเก็บที่อ่างควบคุม อุณหภูมิที่ 35°C แล้วปล่อยให้เกิดการตกผลึกพร้อมบันทึกผลการทดลอง
8. ทำการเก็บผลึกและนำไปวิเคราะห์ผล

ตอนที่ 2.2 ปููกผลึก KDP โดยการเจือ TGS 5% mol

1. ล้างบีกเกอร์ด้วยน้ำ DI ทั้งหมด 2 รอบ
2. นำผลึก KDP และผลึก TGS ที่ปููกได้ในขั้นตอนที่ 1 มาบดให้ละเอียด โดยผ่านกระบวนการ recrystallization จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง
3. ซึ่งสาร KDP ที่ได้จากการบดละเอียดปริมาณ 50 g
4. ทำการละลายสาร KPD ในน้ำ DI ในอัตราส่วน สาร KDP 50 g ต่อน้ำ DI ปริมาณ 180 ml โดยเติมสารที่ละน้อยจนกว่าสารจะหมด
5. ทำการเจือด้วยสาร TGS โดยซึ่งสารปริมาณ 5.90 g (จากการคำนวณในภาคผนวก ก)
6. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการกรองโดยนำสารละลายที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง
7. นำถุงพลาสติกมาเจาะรู นำไปปิดบีกเกอร์ที่ใช้ใส่สารละลาย แล้วนำไปเก็บที่อ่างควบคุม อุณหภูมิที่ 35°C แล้วปล่อยให้เกิดการตกผลึกพร้อมบันทึกผลการทดลอง
8. ทำการเก็บผลึกและนำไปวิเคราะห์ผล

3.3 แผนผังการดำเนินงานและขั้นตอนการปููกผลึกแบบทิศทางเดียว



ภาพที่ 3.2 แผนผังการดำเนินงานการปููกผลึกแบบทิศทางเดียว



จากภาพที่ 3.2 การดำเนินงานการปัลอกผลึกแบบพิเศษเดียว โดยปัลอกผลึก KDP บริสุทธิ์ จากวิธีการปัลอกผลึกแบบดึงเดิน นำมาบดให้ละเอียดแล้วละลายด้วยน้ำ DI เพื่อทำให้เป็นสารละลาย จากนั้นเลือกผลึก KDP บริสุทธิ์ ที่มีคุณภาพดีเพื่อทำเป็นซีด โดยเลือกพิเศษการปัลอกคือ <100> เมื่อได้ผลึกจากการปัลอกแบบพิเศษเดียวแล้วนำผลึกไปศึกษาสมบัติโดยอิเล็กทริก

3.3.1 การปัลอกผลึกแบบพิเศษเดียว

1. ล้างบีกเกอร์และหลอดทดลองด้วยน้ำ DI ทั้งหมด 2 รอบ
2. นำผลึก KDP ที่ปัลอกได้ในขั้นตอนที่ 1 มาบดให้ละเอียด โดยผ่านกระบวนการ recrystallization จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง
3. ชั่งสาร KDP ที่ได้จากการบดละเอียดปริมาณ 50 g
4. ทำการละลายสาร KPD ในน้ำ DI ในอัตราส่วน สาร KDP 50 g ต่อน้ำ DI ปริมาณ 180 ml โดยเติมสารละลายที่ล่อน้อยจนกว่าสารจะหมด
5. ทำการเลือกพิเศษในการปัลอกผลึกแบบพิเศษเดียว โดยพิเศษในการปัลอกคือ <100> ด้วยการนำผลึก KDP บริสุทธิ์ ที่มีคุณภาพดีมาตัดหรือขัดให้ได้ขนาดพอตัวตามความเหมาะสม กับหลอดทดลอง
6. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการกรองโดยนำสารละลายที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง
7. เทสารใส่ในหลอดทดลองที่ได้เลือกพิเศษเดียวในการปัลอกคือ <100>
8. ติดตั้งระบบการปัลอกผลึกแบบบวชพิเศษพิเศษเดียว โดยควบคุมอุณหภูมิต้านบนของระบบที่ อุณหภูมิ 36°C ด้านล่างที่อุณหภูมิ 32°C ปล่อยให้เกิดการแตกผลึกพร้อมบันทึกผลการทดลอง
9. ทำการเก็บผลึกและนำไปวิเคราะห์ผล

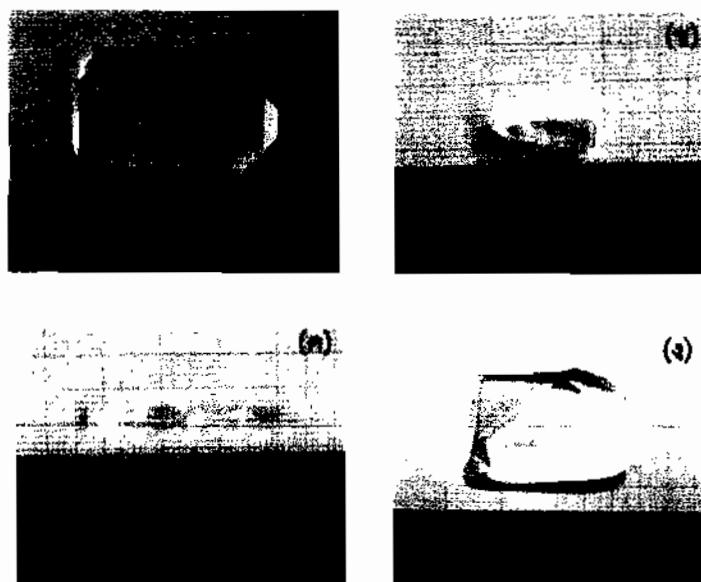


บทที่ 4

ผลการทดลองและอภิปรายผล

ในบทนี้กล่าวถึงผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาสมบัติพื้นฐานของผลึกโพแทสเซียมไดไฮดรอเจนฟอสเฟตเมื่อทำการเจือด้วยไตรีกอลซีบชัลเฟต ด้วยการปัลอกผลึกแบบดั้งเดิมและการปัลอกผลึกแบบทิศทางเดียว โดยกำหนดทิศทางการเกิด $<100>$ ซึ่งจะนำผลึกที่ได้นำเปรียบเทียบคุณลักษณะและวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ของผลึก ได้แก่ ศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ศึกษาหมุนฟังก์ชันด้วยเทคนิค FT-IR ศึกษาพื้นผิวของผลึกด้วยเทคนิค SEM ศึกษาสมบัติโดยเล็กทริกและศึกษาสมบัติไฟฟ้าหรืออิเล็กทริก รายละเอียดของการทดลองและอภิปรายผลมีดังต่อไปนี้

4.1 ลักษณะและอัตราการเจริญเติบโตของผลึก



ภาพที่ 4.1 ผลึกปัลอกแบบบวจดั้งเดิม

- (ก) ผลึก KDP บริสุทธิ์
- (ข) ผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 2% mol
- (ค) ผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol
- (ง) ผลึก TGS

จากภาพที่ 4.1 แสดงผลึกที่ได้จากการปัลอกผลึกด้วยดั้งเดิม โดยผลึกในภาพที่ 4.1(ก) คือ ผลึก KDP บริสุทธิ์ จะเห็นว่าผลึกมีลักษณะผิวน้ำเรียน โปร่งใสและมีความสมบูรณ์ของผลึก ผลึกที่ปัลกได้มีขนาด $4.2 \times 3.3 \times 1.5 \text{ cm}^3$ โดยใช้ระยะเวลาในการปัลก 28 วัน

ภาพที่ 4.1(ข) คือ ผลึก KDP ถูกเจือด้วย TGS 2% mol จะเห็นว่าผลึกมีลักษณะผิวน้ำของผลึกเรียบเป็นแท่งขนาดเล็ก ความโปร่งใสไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของผลึก ผลึกที่ปัลกได้มีขนาด $1.8 \times 0.9 \times 0.5 \text{ cm}^3$ โดยใช้ระยะเวลาในการปัลก 35 วัน

ภาพที่ 4.1(ค) คือ ผลึก KDP ถูกเจือด้วย TGS 5% mol จะเห็นว่าผลึกมีลักษณะเป็นแท่งความกว้างไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของผลึก ผลึกที่ปั้นได้มีขนาด $2.8 \times 0.7 \times 0.5 \text{ cm}^3$ โดยใช้ระยะเวลาในการปั้น 39 วัน

ภาพที่ 4.1(ง) คือ ผลึก TGS มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม ปราการภูเหลี่ยมในหน้าต่างๆ มีผิวน้ำเรียบ โปรดังให้ปั้นได้มีขนาด $2.9 \times 2.6 \times 1.5 \text{ cm}^3$ โดยใช้ระยะเวลาในการปั้น 65 วัน

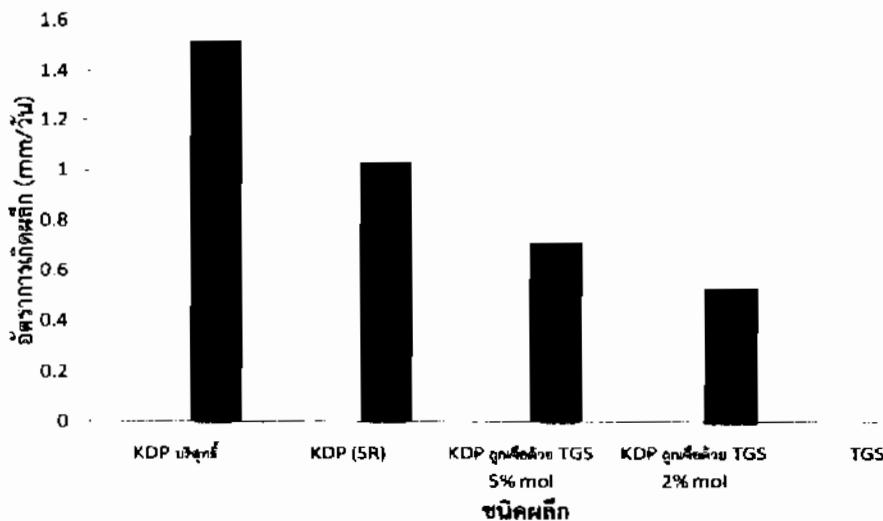
จากลักษณะของผลึกที่ปั้นได้มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ทั้งขนาด รูปทรง และความกว้าง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ อาจเนื่องมาจากการปั้นใช้เวลาในการปั้น จึงส่งผลต่อกระบวนการการเกิดผลึก



ภาพที่ 4.2 ผลึกปั้นแบบทิศทางเดียว

- (ก) ผลึก KDP ปั้นแบบทิศทางเดียว
- (ช) ผลึก KDP ปั้นแบบทิศทางเดียว หลังจากการตัดจากหลอดลอง
- (ค) แผ่นผลึก KDP ปั้นแบบทิศทางเดียว โดยผ่านการขัด

จากภาพที่ 4.2 แสดงผลึกที่ได้จากการปั้นแบบทิศทางเดียว ภาพที่ 4.2 (ก) คือ ผลึก KDP ที่อยู่ในหลอดลอง พบร้ามีลักษณะร่องรอยการแตก อาจเกิดจากความสมบูรณ์ของผลึก ใช้ระยะเวลาปั้น 52 วัน ภาพที่ 4.2 (ช) คือ ผลึก KDP ปั้นแบบทิศทางเดียว หลังจากการตัดจากหลอดลอง พบร้ามีความใส่น้อย ภาพที่ 4.2 (ค) แผ่นผลึก KDP ปั้นแบบทิศทางเดียว โดยผ่านการขัดเห็นได้ว่าผลึกมีลักษณะมีความใส่น้อยมีร่องรอยการแตกปราการภูเห็นได้ชัดเจนอาจเกิดจากความสมบูรณ์ของผลึก ผลึกมีขนาด $1.3 \times 1.5 \times 0.2 \text{ cm}^3$



ภาพที่ 4.3 อัตราการเจริญเติบโตของผลึกที่ปลูกได้

จากภาพที่ 4.3 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของผลึก โดยการปลูกผลึกแบบดั้งเดิมและแบบหิศทางเดียว ดังนี้ ผลึก KDP มีอัตราการเกิดอยู่ที่ 1.5 mm /วัน ผลึก KDP ที่ปลูกแบบหิศทางเดียว มีอัตราการเกิดอยู่ที่ 1 mm /วัน ผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol มีอัตราการเกิดอยู่ที่ 0.7 mm /วัน ผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 2% mol มีอัตราการเกิดอยู่ที่ 0.5 mm /วัน ผลึก TGS มีอัตราการเกิดอยู่ที่ 0.4 mm /วัน จากกราฟบอกได้ว่า ผลึก KDP ที่ปลูกแบบดั้งเดิมมีอัตราการเจริญเติบโตที่มากกว่า ผลึกชนิดอื่นเมื่อเทียบจากการปลูกผลึกแบบเดียวกัน

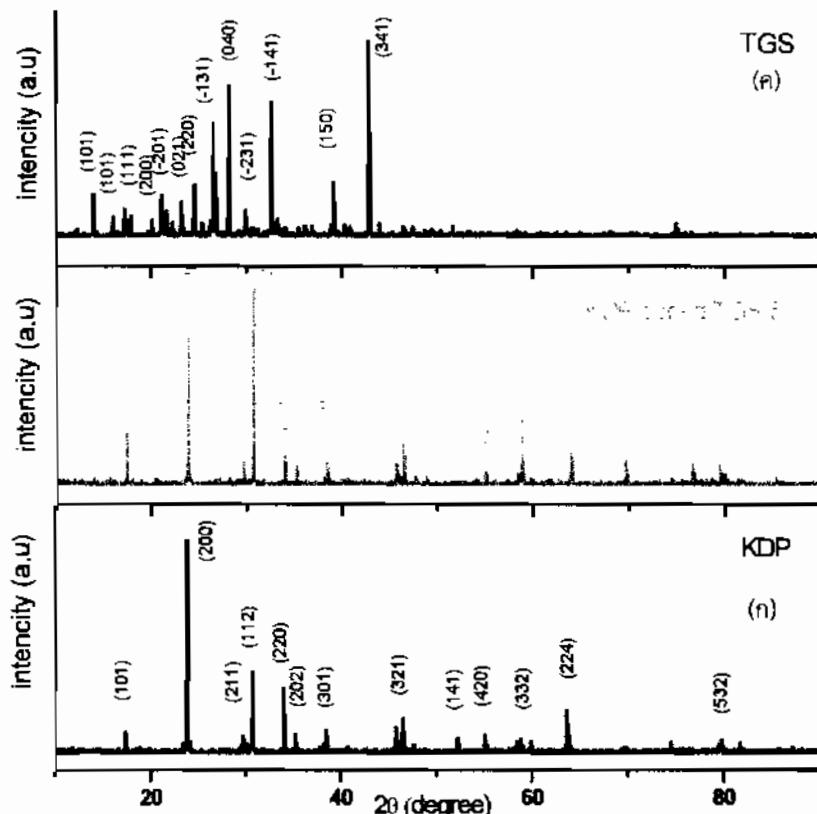
4.2 การศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

การศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผลึก KDP และผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol และผลึก TGS ชิ้นงานตัวอย่างจะถูกเตรียมให้เป็นผงละเอียด โดยใช้มุมเริ่มต้น 2θ ที่ 5° และมุมสุดท้าย 2θ ที่ 90° สเปกตรัมที่แสดงออกม่าจะอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มกับมุม 2θ

จากภาพที่ 4.4 เป็นสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ประกอบด้วย (ก) กราฟ XRD ของ ผลึก KDP บริสุทธิ์ (ข) กราฟ XRD ของ ผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol (ค) ผลึก TGS บริสุทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบกราฟ (ก) และกราฟ (ข) มียอดสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรูปแบบสำหรับสำลูนและถึงรูปแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของผลึก KDP บริสุทธิ์ ในช่วงมุม 2θ ต่างๆ เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ Loretta และคณะ [23] พบว่า มียอดสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรูปแบบสำหรับผลึกที่ปลูกได้ทั้งกรณีผลึกบริสุทธิ์และผลึกที่ถูกเจือมีโครงสร้างแบบเตตระโนนอล โดยผลึก KDP บริสุทธิ์ และผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol มีรูปแบบเกิดขึ้นเหมือนกันคือ (101) (200) (112) (220) (311) แสดงว่าการเจือ TGS ในผลึก KDP ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก KDP เพราะยังมียอดสเปกตรัมการเลี้ยวเบนที่สำลูนครบถ้วน

สำหรับผลึก TGS บริสุทธิ์ ปรากฏยอดสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรูปแบบต่างๆ ในช่วงมุม 2θ ที่ 10° ถึง 40° แสดงดังกราฟ (ค) เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ Balu และคณะ พบว่า มียอด

สเปกตรัมการเลี้ยงเบนของรูบราบสอดคล้องกัน แสดงว่าผลึกที่ปูกลูกได้มีโครงสร้างแบบโมโนคลินิก [24]



ภาพที่ 4.4 สเปกตรัมการเลี้ยงเบนของรังสีเอกซ์

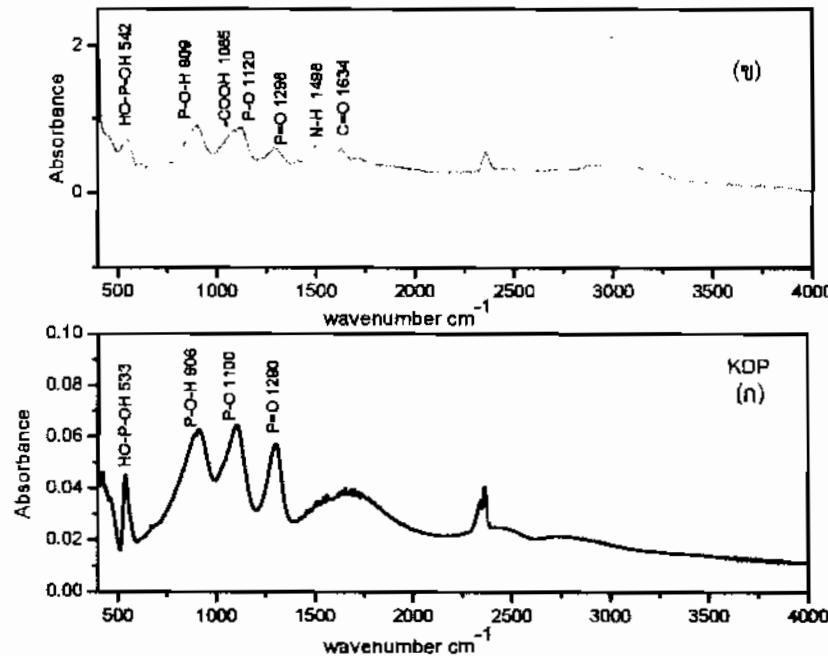
(ก) ผลึก KDP บริสุทธิ์

(ข) ผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol

(ค) ผลึก TGS บริสุทธิ์

4.3 การศึกษาหมู่ฟังก์ชัน

การศึกษาหมู่ฟังก์ชันโดยเทคนิค FT-IR เป็นการวัดการดูดกลืน (absorbance) พลังงานคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงเลขค่านั้นตั้งแต่ $400-4000\text{ cm}^{-1}$ ของผลึก KDP บริสุทธิ์ และผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol โดยใช้เครื่อง PERKIN ELMER spectrum GX FT-IR system สำหรับการนำผลึกไปตรวจสอบ ผลึกตัวอย่างจะถูกบดให้เป็นผงละเอียดแล้วนำไปผสมกับสาร KBr จากนั้นนำไปอัดให้เป็นแผ่นบาง ผลการวัดในแต่ละสเปกตรัมจะแสดงการสั่นของพันธะ ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันภายในโมเลกุล ดังแสดงในภาพที่ 4.5



ภาพที่ 4.5 สเปกตรัม FT-IR สำหรับการวิเคราะห์หมุนฟังก์ชันของผลึก

(ก) ผลึก KDP บริสุทธิ์

(ข) ผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol

ภาพที่ 4.5 แสดงสเปกตรัมการคูตุคลีนแสงอินฟราเรดในช่วงเลขคีนตั้งแต่ 400-4000 cm⁻¹ ของผลึก KDP บริสุทธิ์ และผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4.5 (ก) พบว่ามียอดสเปกตรัมการคูตุคลีนแสงอินฟราเรดของผลึก KDP ดังนี้ ยอดที่เลขคีน 533 cm⁻¹ ซึ่งเป็นผลจากการสั่นของพันธะ OH-P-OH ยอดที่เลขคีน 906 cm⁻¹ เป็นผลจากการสั่นของพันธะ P=O-H ยอดที่เลขคีน 1100 cm⁻¹ เป็นผลจากการสั่นของพันธะ P-O ยอดที่เลขคีน 1299 cm⁻¹ เป็นผลจากการสั่นของพันธะ P=O และในช่วงยอดที่เลขคีน 2400 - 3500 cm⁻¹ เป็นผลจากการสั่นจากพันธะ O-H เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ Balamurugan และ Ramasamy [7] พบว่า มียอดสเปกตรัมการคูตุคลีนแสงอินฟราเรดที่สอดคล้องกัน แสดงว่าไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในผลึกที่ได้ คือ ไม่เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการรวมตัวกันเป็นโพแทสเซียมไดอิโตรเจนฟอสเฟต ดังนั้น การป้องกันจากสารละลาย ทำให้อ่อนในสารละลายกลับมาร่วมตัวกันเป็นโพแทสเซียมไดอิโตรเจนฟอสเฟต

ภาพที่ 4.5(ข) พบว่ายอดสเปกตรัมการคูตุคลีนแสงอินฟราเรดของผลึก KDP ที่ถูกเจือ เลื่อนจากค่ามาตรฐาน เนื่องจากการเจือสาร TGS อาจส่งผลต่อการสั่นของพันธะของ KDP ได้ผลดังนี้ ยอดที่เลขคีน 533 cm⁻¹ เลื่อนเป็น 542 cm⁻¹ เป็นผลจากการสั่นของพันธะ OH-P-OH ยอดที่เลขคีน 906 cm⁻¹ เลื่อนเป็น 909 cm⁻¹ เป็นผลจากการสั่นของพันธะ P=O-H ยอดที่เลขคีน 1100 cm⁻¹ เลื่อนเป็น 1120 cm⁻¹ เป็นผลจากการสั่นของพันธะ P-O ยอดที่เลขคีน 1299 cm⁻¹ เลื่อนเป็น 1298

cm^{-1} เป็นผลจากการสันของพันธะ $\text{P}=\text{O}$ จากผลดังกล่าวพบว่าการเจือสาร TGS ส่งผลให้ยอดสเปกตรัมมีเลขค่าสูงเพิ่มขึ้น แสดงว่าการเจือ TGS ทำให้ความถี่การสันของพันธะเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังพบยอดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของ TGS ดังนี้ ยอดที่เลขค่าสูง 1085 cm^{-1} เป็นผลจากการสันของพันธะ $-\text{COOH}$ ยอดที่เลขค่าสูง 1634 cm^{-1} เป็นผลจากการสันของพันธะ $\text{C}=\text{O}$ เมื่อเทียบยอดสเปกตรัมดังกล่าวกับงานวิจัยของ Baiju และคณะ [24] พบว่า ผลลัพธ์ที่ปรากฏได้มีโมเลกุลของ TGS เข้าไปแทรกตัวอยู่ในโครงสร้างผลึก KDP ที่ถูกเจือ

4.4 การศึกษาลักษณะสัญญาณวิทยาของผลึก

การศึกษาลักษณะสัญญาณวิทยาของผลึก KDP บริสุทธิ์ ผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 2% mol และผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol โดยศึกษาจากภาพถ่ายของกล้องชุลทรรศน์อิเล็กทรอนแบบส่องกราด ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-6460LV โดยเตรียมชิ้นงานสำหรับถ่ายภาพด้วยกล้อง SEM ให้มีขนาดความหนา 2-3 mm จากนั้นนำชิ้นงานไปผ่านกระบวนการเคลือบฟิล์มบางทอง

ภาพที่ 4.6(ก) เป็นลักษณะพื้นผิวของผลึก KDP บริสุทธิ์ ที่ได้จากการใช้ศักยไฟฟ้า 12 kV ภาพที่ได้มีลักษณะเป็นทรงเรขาคณิต โดยมีขนาดแฉลเด้านแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม รูปทรงสัญญาณ มีลักษณะตรงกับผลึกที่ถูกรายงานโดย Dongli Xu [25] ส่วนลักษณะพื้นผิวของผลึกที่ถูกเจือ ในภาพที่ 4.6(ข) และภาพที่ 4.6(ค) เป็นลักษณะพื้นผิวของผลึก ในการเจือที่ถูกเจือด้วย TGS 2% mol และ 5% mol ซึ่งพื้นผิวผลึกมีลักษณะเป็นแท่งยาว แต่ต้องอย่างไรก็ตาม สเปกตรัมจากการวัด XRD แสดงให้เห็นว่า ขนาดของยูนิตเซลล์ของผลึก KDP บริสุทธิ์ และที่ถูกเจือด้วย TGS มีค่าเท่ากัน ภาพที่ได้จากกล้อง SEM จึงควรมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ลักษณะที่แตกต่างกันในภาพที่ 4.6 อาจไม่ใช่ลักษณะสัญญาณของโมเมนต์ KDP แต่อาจเป็นลักษณะพื้นผิวที่เกิดจากคราบของสารละลายที่เหลือค้างในระหว่างการเก็บผลึก



ภาพที่ 4.6 ลักษณะพื้นผิวของผลึกที่ปลูกได้

(ก) ลักษณะพื้นผิวของผลึก KDP บริสุทธิ์

(ข) ลักษณะพื้นผิวของผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 2% mol

(ค) ลักษณะพื้นผิวของผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol

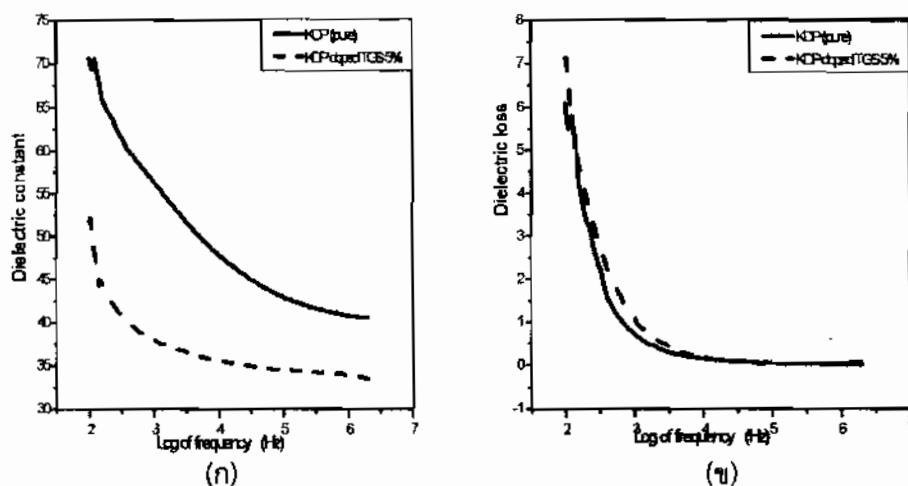
4.5 การศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริก

การศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของผลึก KDP สามารถทำได้โดยตัดชิ้นผลึกตัวอย่างให้เป็นแผ่นบาง ความหนา 2 mm และเคลื่อนที่ความถี่ที่ด้านหน้าและหลัง เพื่อทำให้เกิดโครงสร้างของตัวเก็บประจุ และใช้เครื่อง Agilent E4980A วัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ที่ความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ที่อุณหภูมิห้อง

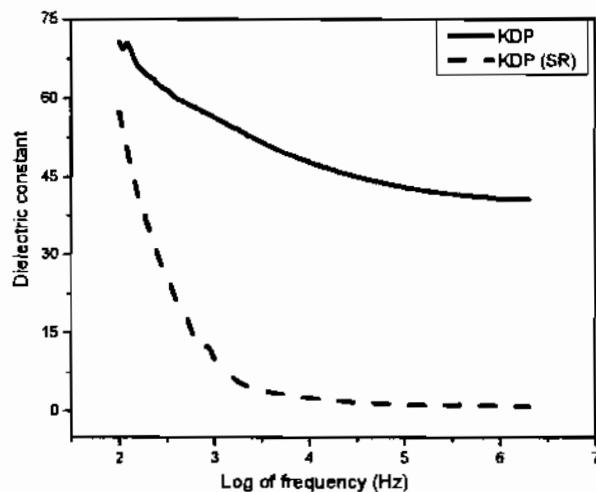
ภาพที่ 4.7(ก) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึก KDP บริสุทธิ์ และที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol ค่าคงที่ของไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึก KDP บริสุทธิ์ มีค่ามากกว่าของผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol โดยมีค่าคงที่ของไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์สูงสุดของผลึก KDP บริสุทธิ์ คือ 73 ส่วนผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol มีค่าคงที่ของไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์สูงสุด คือ 53 ที่ความถี่ 100 Hz

เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น พบว่าค่าคงที่ของไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์จะลดลง และเริ่มคงที่ เมื่อความถี่มากกว่า 10 kHz นั้นแสดงว่า ที่ความถี่มากกว่า 10 kHz ไดโอลไม่menต์ไม่สามารถถูกลับตัวตามที่ศึกษานามไฟฟ้า [26] เมื่อเจือ TGS ลงในผลึก KDP พบว่าค่าคงที่ของไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์มีค่าลดลง อาจเกิดจาก TGS ไปแทรกตัวอยู่ภายในโครงสร้างผลึก KDP ส่งผลต่อการจัดเรียงตัวไดโอลของผลึก KDP ทำให้การตอบสนองต่อสถานะไฟฟ้าลดลง [27]

ภาพที่ 4.7(ข) แสดงค่าสูญเสียไดอิเล็กทริกของผลึก KDP บริสุทธิ์ และที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol จากกราฟพบว่าผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol มีค่าสูญเสียไดอิเล็กทริกมากกว่า กรณีผลึก KDP บริสุทธิ์ แสดงให้เห็นว่า การเจือส่งผลให้มีพาราเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดกระแสรั่วเพิ่มขึ้น ตั้งนั้น ความสามารถในการเก็บพลังงานในรูปแบบไฟฟ้าลดลง [26-28]



ภาพที่ 4.7 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก
 (ก) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึก KDP และผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol
 (ข) ค่าสูญเสียไดอิเล็กทริกของผลึก KDP และผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol

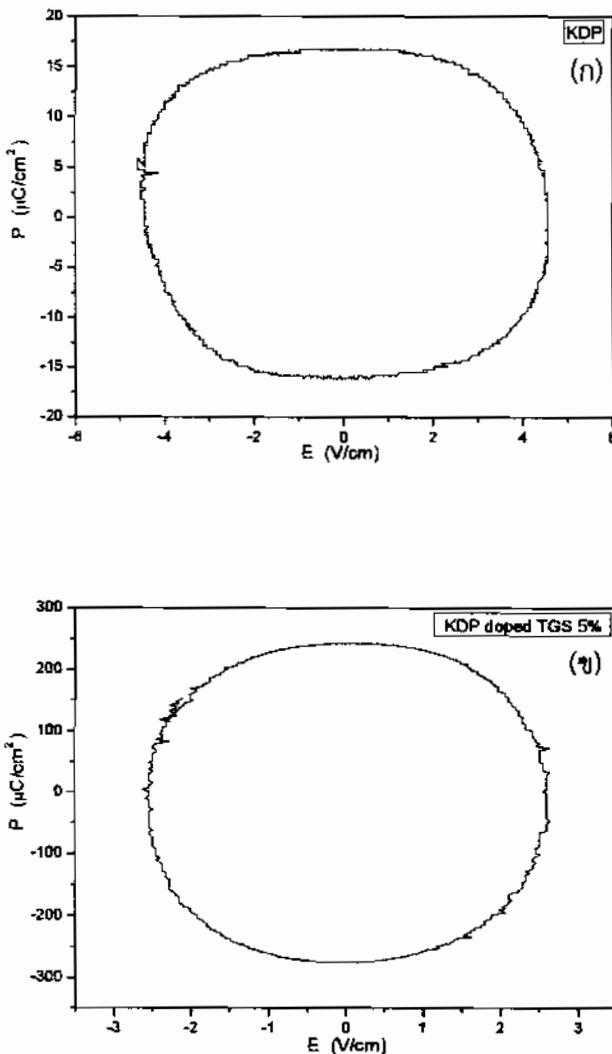


ภาพที่ 4.8 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึก KDP ที่ปลูกแบบดั้งเดิม และผลึก KDP ที่ปลูกแบบทิศทางเดียว (SR)

ภาพที่ 4.8 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึก KDP บริสุทธิ์ ที่ถูกปลูกแบบดั้งเดิมและที่ถูกปลูกแบบทิศทางเดียว พนวณผลึกที่ปลูกแบบดั้งเดิมมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์มากกว่าผลึกที่ปลูกแบบทิศทางเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึก KDP ที่ปลูกแบบทิศทางเดียว พบว่าบางช่วงความถี่ ค่าที่วัดได้น้อยกว่า 1 ซึ่งขัดแย้งกับค่าเชิงทฤษฎี แสดงให้เห็นว่า อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นในขณะที่ทำการวัด ดังนั้น จึงควรทำการวัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริกซ้ำ เพื่อดูเส้นแนวโน้มค่าที่วัดได้ที่ถูกต้อง เพราะจากทฤษฎีการปลูกแบบทิศทางเดียวควรได้ผลลัพธ์ที่มีความสมบูรณ์มากกว่าผลึกที่ปลูกแบบดั้งเดิม ดังนั้น ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึกที่ปลูกแบบทิศทางเดียวจึงควรสูงกว่าผลึกที่ปลูกแบบบิชตี้ดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม หากแนวโน้มที่ได้ตามภาพที่ 4.8 เป็นจริง แสดงว่า ผลึกที่ปลูกแบบทิศทางเดียวในโครงงานนี้มีความบกพร่องของผลลัพธ์มาก ทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ต่ำ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการปลูกผลึกแบบทิศทางเดียว [9]

4.7 การศึกษาสมบัติเพื่อเรืออิเล็กทริก

การศึกษาสมบัติเพื่อเรืออิเล็กทริกของผลึก KDP บริสุทธิ์ และที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol เป็นการวัดค่าไฟโลaire เซนท์ที่เกิดขึ้นภายในผลึก ผลที่ได้อยู่ในรูปของกราฟระหว่างค่าไฟโลaire เซนท์กับค่าสนามไฟฟ้า โดยสามารถเตรียมชิ้นผลึกตัวอย่างได้โดยตัดให้เป็นแผ่นบาง ความหนา 2 mm จากนั้นเคลือบการเงินไว้ที่ด้านข้างทั้ง 2 ของชิ้นงาน และใช้วงจร Sawyer-Tower circuit วัดค่าไฟโลaire เซนท์ ที่อุณหภูมิ 0 °C [6] ได้ผลแสดงดังภาพที่ 4.9



ภาพที่ 4.9 ความสัมพันธ์ของ P และ E

(ก) ผลึก KDP บริสุทธิ์

(ข) ผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol

ภาพที่ 4.9 แสดงลักษณะสมบัติค่าโพลาไรเซชันของผลึก KDP บริสุทธิ์ และที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol กราฟที่ได้มีลักษณะโพลาไรเซชันตรงกับกราฟในภาพที่ 2.16 ซึ่งเป็นลักษณะของตัวด้านหน้าแบบเชิงเส้นในอุณหภูมิ แสดงว่า ผลึกที่ปัจจุบันไม่สามารถเก็บสะสมพลังงานในรูปสถานไฟฟ้าได้ เนื่องจากผลึก KDP แสดงสมบัติเพอร์โอะลีเอ็กทริกที่อุณหภูมิต่ำกว่า 122 K แต่ในการวัดค่าโพลาไรเซชันในโครงงานนี้ ถูกวัดที่อุณหภูมิ 273 K ทำให้ได้ผลไม่เหมือนไม่สามารถรวมตัวกันเกิดโดยmenของเพอร์โอะลีเอ็กทริกได้ [29]

การเจือ TGS ลงในพลีก KDP พบร้า ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของพลีก KDP ได้ อาจเนื่องจากปริมาณความเข้มข้นของ TGS ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เกิดโคลเมนของเฟอร์โรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิ 273 K [29]



บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาการปลูกผลึกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึก KDP บริสุทธิ์ และผลึก KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS ในปรอร์เซ็นโน้มลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 2% mol และ KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS 5% mol ที่ปลูกแบบดั้งเดิมและการศึกษาลักษณะเฉพาะของผลึก KDP บริสุทธิ์ ที่ปลูกแบบทิคทางเดียว เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมบัติจากสองวิธี โดยการนำผลึกไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD FT-IR SEM และศึกษาสมบัติโดยอิเล็กทริกศึกษาสมบัติเพื่อรีโรอิเล็กทริก ในการทดลองนี้สามารถสรุปผลโดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 สรุปผลการทดลอง

การศึกษาการเลี้ยงเบนของรังสีเอกซ์

ผลจากการศึกษาด้วยเทคนิค XRD ของผลึก KDP โดยการเจือสาร TGS ในปรอร์เซ็นโน้มลที่แตกต่างกัน ไม่พบการเปลี่ยนโครงสร้างของผลึก KDP

การศึกษามุ่ฟังก์ชันโดยเทคนิค FT-IR

การศึกษามุ่ฟังก์ชันของผลึก KDP จากเทคนิค FT-IR เมื่อเทียบจากลักษณะของเส้นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟราเรด มีลักษณะสเปกตรัมที่คล้ายคลึงกัน แสดงให้เห็นว่าผลึกที่ปลูกได้มีการแทรกตัวของโมเลกุล TGS ในโครงสร้างของผลึก KDP

การศึกษาลักษณะสัญญาณวิทยาของผลึก

การศึกษาลักษณะสัญญาณวิทยาของผลึก พบว่า ภาพที่ได้จากการถ่าย SEM ในโครงงานนี้ไม่สามารถแสดงลักษณะสัญญาณของผลึกที่ปลูกได้ แต่อาจเป็นภาพที่แสดงครรภของสารละลายที่เหลือค้างในขณะที่เก็บผลึก

การศึกษาสมบัติโดยอิเล็กทริก

การศึกษาสมบัติโดยอิเล็กทริกของผลึก พบว่า การเจือ TGS ลงในผลึก KDP บริสุทธิ์ ไม่มีผลต่อค่าคงที่โดยอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึก KDP อย่างไรก็ตาม วิธีการปลูกผลึกส่งผลต่อค่าคงที่โดยอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลึก KDP

การศึกษาสมบัติเพื่อรีโรอิเล็กทริก

การศึกษาสมบัติเพื่อรีโรอิเล็กทริก พบว่า การเจือ TGS ลงในผลึก KDP ไม่ส่งผลต่อสมบัติเพื่อรีโรอิเล็กทริกของผลึก KDP แต่ลักษณะโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นแสดงลักษณะสมบัติของด้านหน้าแบบเชิงเส้นในอุณหภูมิ



5.2 ปัญหาจากการทดลองและข้อเสนอแนะ

ปัญหา

- การศึกษาภาพถ่ายจากกล้อง SEM ไม่สามารถเปรียบเทียบลักษณะสันฐานวิทยาได้
- การศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ไม่ได้ผลตามดั่งเดิมเชิงทฤษฎี
- การปลูกผลลัพธ์แบบทิศทางเดียวไม่สามารถปลูกผลลัพธ์ให้มีความสมบูรณ์ตามทฤษฎี
- การศึกษาสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกไม่พบการสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกเกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- การศึกษาภาพถ่ายจากกล้อง SEM ควรเตรียมชิ้นงานโดยการย้อมสีเพื่อให้เห็นขอบของเกรนผลลัพธ์
 - การศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของผลลัพธ์ ควรเตรียมชิ้นผลลัพธ์อย่างระมัดระวัง เพื่อให้ผิวสัมผัสของข้าวไฟฟ้าติดแน่นกับผิวของผลลัพธ์และไม่สัมผัสกัน
 - การปลูกผลลัพธ์แบบทิศทางเดียว ควรควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิดผลลัพธ์ ได้แก่ อุณหภูมิ สีเงื้อป่นด่างฯ เป็นต้น
 - การศึกษาสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก ควรเปลี่ยนอุณหภูมิในการวัดและเพิ่มปริมาณสารที่เจือลงในผลลัพธ์

บรรณานุกรม

- [1] P. Ramasamy, P. Santhanaraghavan, Crystal growth processes and methods, KUR publication (2001).
- [2] C. Justin Raj, S. Krishnan, S. Dinakaran, R. UthraKaran, S. Jerome Das, Growth and optical absorption studies on potassium dihydrogen phosphate single crystal, **Crystal Research Technology**, 43 (2008) 245–247.
- [3] S. Balamurugan, P. Ramasamy, Yuttapong Inkong, Prapun Manyum, Effect of KCL on the bulk growth KDP crystals by Sankaranarayanan-Ramasamy method, **Materials Chemistry and Physics**, 113 (2009) 622-625.
- [4] R. Krishnamurthy, R. Rajasekaran, Bincy Susan Samuel, Growth and characterization of KDP crystals doped with L-aspartic acid, **Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy**, 104 (2013) 310–314.
- [5] I.N. Ogorodnikov, V.A. Pustovarov, V.M. Puzikov, V.I. Salo, A.P. Voronov, A luminescence and absorption spectroscopy study of KH_2PO_4 crystals doped with Tl^+ ions, **Optical Materials**, 34 (2012) 1522–1528.
- [6] K. Cwikiel, B. Fugiel, M. Mierzwa, Quasi-stable states of TGS ferroelectric induced by an electric field perpendicular to the ferroelectric axis, **Physica B: Condensed Matter**, 296 (2001) 361–36B.
- [7] [3] S. Balamurugan, P. Ramasamy, Growth and characterization of unidirectional $<100>$ KDP single crystal by Sankaranarayanan–Ramasamy (SR) method, **Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy**, 71 (2009) 1979–1983.
- [8] សុភាសិនី គិនបានុរាង កែវត្រព្យកម្មការសែនក្រោងស្ថានទូទៅ ឆ្នាំ 2552
- [9] K. Sankaranarayanan, P. Ramasamy, Unidirectional seeded single crystal growth from solution of benzophenone, **Journal of Crystal growth**, 208 (2005) 467–473.
- [10] Urit Charoen-in, P. Ramasamy, P. Manyum, Unidirectional growth of organic nonlinear optical L-arginine maleate dihydeate single crystal by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) method and its characterization, **Journal of Crystal growth**, 318 (2011) 745–750.
- [11] Urit Charoen-in, P. Ramasamy P. Manyum, Compararitive study on L-arginine maleate dihydeate single crystal by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) method and conventional slow evaporation solution technique, **Journal of Crystal growth**, 312 (2011) 3269–3275.



บรรณานุกรม (ต่อ)

- [12] Yusuke Asakuma, Qin Li, H. Ming Ang, Moses Tade, Kouji Maeda, Keisuke Fukui, A study of growth mechanism of KDP and ADP crystals by means of Quantum, **Chemistry, Applied Surface Science**, 254 (2008) 4524–4530.
- [13] C. Justin Raj, S. Krishnan, S. Dinakaran, R. Utharakumar, S. Jerome Das, Growth and optical absorption studies on potassium dihydrogen phosphate single crystal, **Crystal Research Technology**, 43 (2008) 245–247.
- [14] N. Balamurugan, M. Lenin, G. Bhagavannarayana, P. Ramasamy, Growth of TGS Crystal using uniaxially solution-crystallization method of Sankaranarayanan-Ramasamy (SR), **Crystal Research Technology**, 42 (2007) 151–156.
- [15] Geochemical Instrumentation and Analysis [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก (<http://serc.carleton.edu/XRD.html>) (วันที่สืบค้น 23 มกราคม 2556)
- [16] (http://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/techniques/XRD.html) [ออนไลน์] (วันที่สืบค้น 22 มกราคม 2556)
- [17] แม่น ออมรศิทธิ์ และคณะ. หลักการและเทคนิคิเคราะห์เครื่องมือ.กรุงเทพฯ 2554
- [18] สันติ กระแสงเทห การเตรียมและสมบัติทางแม่เหล็กของ CoFe_2O_4 และ NiFe_2O_4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
- [19] Dielectric properties [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก (http://www.doitpoms.ac.uk/tplib/dielectrics/dielectric_constant.php) (วันที่สืบค้น 22 มกราคม 2556)
- [20] www.doitpoms.ac.uk/tplib/ferroelectrics/printall.php [ออนไลน์] (วันที่สืบค้น 31 พฤษภาคม 2556)
- [21] Ferroelectric [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก (http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2548/mat0948sh_ch2.pdf) (วันที่สืบค้น 22 มกราคม 2556)
- [22] Ferroelectric [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก ([http://interactive.npl.co.uk/multiferroics/images/7/7a/CMMT_A\(152\).pdf](http://interactive.npl.co.uk/multiferroics/images/7/7a/CMMT_A(152).pdf)) (วันที่สืบค้น 13 พฤษภาคม 2556)
- [23] Fernando Loretta, T. Josephine Rani, P. Selvarajan, S. Perumal, S.Ramalingom, Growth, structural and optical studies of pure and bisthiourea zinc chloride doped potassium dihydrogen phosphate single crystals, **World Journal of Science and Technology**, 1(3) 2011 01-06.
- [24] T. Balu , T.R. Rajasekaran , P. Murugakoothan, Studies on the growth, structural, optical and mechanical properties of ADP admixed TGS crystals, **Current Applied Physics** 9 (2009) 435–440.

บรรณานุกรม (ต่อ)

- [25] Dongli Xu, Dongfeng Xue, Morphology control of KDP crystallites, **Physica B: Condensed Matter**, 370: 84-89.
- [26] N.B. Singh, T.A. Gould, R.H. Hopkins, Etching studies on crystals of thallium arsenic selenide, **Journal of Crystal Growth**, 78 (1986) 43–50.
- [27] M. Senthil Pandian, P. Ramasamy, Unidirectional growth of <0 0 1> tetra glycine barium chloride (TGBC) single crystal by Sankaranarayanan–Ramasamy method, **Journal of Crystal Growth**, 311 (2009) 944-947.
- [28] K. Rajarajan, S. Selvakumar, Ginson P. Joseph, S. Samikkannu, I. Vetha Potheher, P. Sagayara, Optical, dielectric and photoconductivity studies of bis(dimethylsulfoxide) tetrathiocyanato-cadmium(II) mercury(II) NLO single crystals, **Optical Materials**, 28 (2006) 1187-1191.
- [29] Dalibor Merunka, Boris Rakvin, Correlation between hydrogen bond geometry and phase transition temperature in KDP-type ferroelectrics, **Chemical Physics Letters**, 393 (2004) 558-562.



ການພົບກ



การคำนวณค่าไดอิเล็กทริก

คำนวณได้จากสมการ

$$\epsilon' = \frac{C_p d}{\epsilon_0 A}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

ข้อมูลผลลัพธ์ KDP ที่ใช้คำนวณ $d = 0.00145 \text{ m}$, $A = 0.00003959 \text{ m}^2$

ข้อมูลผลลัพธ์ KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS ที่ใช้คำนวณ $d = 0.00125 \text{ m}$, $A = 0.00001528 \text{ m}^2$

การคำนวณเพอร์เซ็นต์ไดอิเล็กทริก

คำนวณได้จากสมการ

$$\text{Polarization; } P = CV/A$$

$$E = V/D$$

เมื่อ P คือ โพลาไรเซชัน

C คือ ความจุไฟฟ้า

V คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า

A คือ พื้นที่ของชิ้นงาน

E คือ สนามไฟฟ้า

D คือ ความหนาของชิ้นงาน

ข้อมูลผลลัพธ์ KDP ที่ใช้คำนวณ $D = 2.32 \text{ mm}$ $R = 0.98 \text{ mm}$ $A = \pi r^2 = 301.6 \text{ mm}^2$

ข้อมูลผลลัพธ์ KDP ที่ถูกเจือด้วย TGS ที่ใช้คำนวณ $D = 2.02 \text{ mm}$ $R = 1.155 \text{ mm}$

$$A = \pi r^2 = 418.8 \text{ mm}^2$$

$$E = (2000 * 10^{-3} * \text{channel B}) / ((D * 1000) / 100)$$

$$P = ((10^{-6} * \text{channel C} * 10^{-3} * 10) / (A / 1000)) * 1000000$$

หมายเหตุ ถ้า mV ให้คูณ 10^{-3} และ ไม่มี mV ไม่ต้องคูณ 10^{-3} ทั้ง Channel A และ Channel B

การคำนวณหาอัตราส่วนเบอร์เช่นการเจือสาร TGS

การคำนวณเบอร์เช่นในการเจือสาร TGS 2% mol

ถ้าต้องการเจือสาร TGS 2% mol ในสาร KDP ปริมาณ 50 g สามารถทำได้โดยนำสาร TGS ปริมาณ 2.37 g มาผสมในขั้นตอนการเตรียมสารละลายซึ่งปริมาณการเจือตั้งกล่าวสามารถคำนวณจาก



$$\text{โมล} = \frac{\text{มวล (g)}}{\text{มวลโมเลกุล (g/mol)}}$$

$$\text{mol} = \frac{\text{KDP(g)}}{136.09(\text{g/mol})}$$

$$= \frac{50(\text{g})}{136.09(\text{g/mol})}$$

$$= 0.367(\text{mol})$$

เปอร์เซ็นในการเจือคือ 2% กำหนดคือตัวแปร x จะได้ว่า

$$\frac{x}{0.367} = \frac{2\%}{100}$$

$$x = 0.00734$$

มวลโมเลกุลของ TGS 323.28 จะได้

$$0.00734 \times 323.28 = 2.37 \text{ g}$$

ดังนั้น เปอร์เซ็นในการเจือสาร TGS 2% mol = 2.37 g

ในทำนองเดียวกันในการเจือสาร TGS 5% mol = 5.90 g



ประวัติย่อผู้วิจัย

ประวัติผู้ทำการศึกษา

ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป
วันเกิด 26 สิงหาคม 2534
ที่อยู่ปัจจุบัน 80/1 ม.2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
อีเมลล์ i-k-ch@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0836779399

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2545 สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาจากโรงเรียนหนองชาตพิทยาคม
- พ.ศ. 2548 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนครชุมแก่น
- พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนครชุมแก่น
- พ.ศ. 2556 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศิลกศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงาน

นำเสนอผลงานในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 ในรูปแบบ โปสเตอร์ เรื่อง Unidirectional growth of triglycine sulphate doped potassium dihydrogen phosphate single crystal and its characteristics.

นำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 12 ในรูปแบบ โปสเตอร์ เรื่อง Growth of TGS doped KDP and tartaric acid doped ADP and their characterization.

